

Modulhandbuch Master

Optronik

Prüfungsordnungsversion: 2008

gültig für das Studiensemester: Sommersemester 2013

Erstellt am: Freitag 06. September 2013
aus der POS Datenbank der TU Ilmenau

Herausgeber: Der Rektor der Technischen Universität Ilmenau

URN: urn:nbn:de:gbv:ilm1-mhba-9461

- Archivversion -

Modulhandbuch

Master Optronik

Prüfungsordnungsversion:2008

Erstellt am:
Freitag 06 September 2013
aus der POS Datenbank der TU Ilmenau

Inhaltsverzeichnis

Name des Moduls/Fachs	1.FS	2.FS	3.FS	4.FS	5.FS	6.FS	7.FS	Abschluss	LP	Fachnr.
	VSP	VSP	VSP	VSP	VSP	VSP	VSP			
Bauelemente der Optik								FP	6	
Bewertung optischer Systeme	2 0 0							PL 30min	3	880
Fertigungsverfahren optischer Bauelemente und Systeme		2 0 0						PL 90min	3	7513
Projektseminar								FP	12	
Projektseminar Optronik								PL	12	8651
Photonik								FP	18	
Laserphysik 1	2 0 0							PL 30min	3	7517
Molekülphysik und Spektroskopie	3 1 0							PL 30min	5	670
Laserphysik 2		1 1 0						PL 30min	3	7518
Lichtstreuung und Partikelmesstechnik		1 1 0						PL 30min	3	684
Ultramikroskopie		1 0 1						PL 30min	4	7519
Optotechnik								FP	18	
Herstellung optischer Werkstoffe	2 0 1							PL 30min	4	386
Justierung	1 1 0							PL	3	280
Mechanisch-optische Funktionsgruppen 1	2 1 0							PL	4	5959
Digitale Bildverarbeitung 2		2 0 1						PL 90min	4	7410
Mechanisch-optische Funktionsgruppen 2		1 1 0						PL	3	7469
Optische Sensor- und Informationstechnik								FP	18	
Optische Sensoren und Empfänger	2 0 0							PL 30min	4	7525
Photovoltaik und Energiewandlung	2 1 0							PL 30min	4	7526
Mikro- und Nanotechnologien für die Optoelektronik		2 0 0						PL 30min	3	7524
Optische Telekommunikationstechnik 2		2 0 0						PL 30min	3	5191
Informationstheorie und Codierung		2 1 0						PL 30min	4	1378
Wahlfächer								FP	24	
2D-Systemtheorie	2 0 0							PL 30min	5	5585
Fertigungs- und Lasermesstechnik 2	2 0 0							PL 30min	3	5556
Festkörperlaser und Verstärker	2 0 0							PL 30min	3	7537
Holographie	2 0 0							PL 30min	3	885
Lichtmesstechnik und -sensorik	2 1 0							PL 30min	4	318
Mikrooptik 2	1 1 0							PL 30min	3	886

Mikrotechnologie	2 0 0				PL 90min	3	1607
Mikro- und Nanoanalytik		2 0 0				PL 30min	4 5626
Optische Emittter für die Sensor- und Informationstechnik	2 0 0					PL 30min	3 7530
Optische Koordinatenmesstechnik	2 1 0					PL 30min	4 403
Optische Messtechnik/ Optik-Praktikum	1 0 1					PL 30min	3 882
Optoelektronische Mess- und Sensortechnik	3 1 0					PL 30min	5 5559
Physiologische Optik und Psychophysik	1 1 0					PL 30min	3 7485
Silizium-Photovoltaik		1 1 0				PL 30min	3 7362
SMD- und Hybridtechnik (AVT-Workshop)	2 0 0					PL 30min	3 67
Synthese optischer Systeme/ Optiksoftware	1 1 0					PL 30min	3 883
Beleuchtungstechnik		2 1 0				PL 30min	4 316
Digitale Signalverarbeitung	2 1 0					PL 90min	4 1356
Farbe und Farbmetrik		2 0 1				PL 30min	4 317
Lasertechnik		2 0 0				PL 30min	3 881
Messdatenauswertung und Messunsicherheit		2 0 0				PL 30min	3 7451
Metrologie und Qualitätssicherung		2 0 0				PL 30min	3 7535
Nano- und Lasermesstechnik		2 0 1				PL 30min	4 413
Organische Photovoltaik	1 1 0					PL 30min	3 7363
Photovoltaikanlagen		2 0 0				PL 30min	3 5499
Praktikum Lichttechnik		0 0 3				PL	3 325
Praktikum Photovoltaik	0 0 1					PL 30min	1 7364
Systemtechnik der Bildverarbeitung		4 0 2				PL 30min	8 5582
Masterarbeit mit Kolloquium						FP	30
Masterarbeit - Abschlusskolloquium						PL 30min	5 7440
Masterarbeit - schriftliche wissenschaftliche Arbeit						MA 6	25 7439

Modul: Bauelemente der Optik

Modulnummer7512

Modulverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Sinzinger

Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert

Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über Kenntnisse und Überblickswissen zu Funktionsweise, Herstellung und Bewertung optischer Bauelemente und Systeme. Ziel der Kurse dieses Moduls ist es, Wissen über die grundlegenden Aufgaben, Funktionen und Eigenschaften von optischen Bauelementen und Systeme zu vermitteln, die Prinzipien zu erklären, auf deren Grundlagen optische Systeme arbeiten und bewertet werden können. Sie lernen optische Apparate als strukturierte Systeme aus Komponenten mit individuellen Aufgaben und hochgradig komplexen Beziehungen verstehen und erwerben die Fähigkeit, optische Bauelemente und Systeme bezüglich ihrer Leistungen in unterschiedlichen Anwendungsdomänen zu analysieren, bewerten und einzusetzen sowie die Komplexität deren Herstellungsverfahren zu beurteilen.

Vorraussetzungen für die Teilnahme

Fächer des Bachelor-Studiums Optische Systemtechnik/Optronik

Detailangaben zum Abschluss

Master Optronik 2008

Modul: Bauelemente der Optik

Bewertung optischer Systeme

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min

Art der Notengebung: Gestufte Noten

Sprache: Deutsch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 880

Prüfungsnummer: 2300122

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Sinzinger

Leistungspunkte: 3

Workload (h): 90

Anteil Selbststudium (h): 68

SWS: 2.0

Fakultät für Maschinenbau

Fachgebiet: 2332

SWS nach Fachsemester	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	0	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden analysieren optische Abbildungssysteme verschiedenster Art. Sie verstehen die Ursachen für Abbildungsfehler im nicht-paraxialen Bereich und wenden vertiefte Kenntnisse der Beschreibung optischer Bauelemente und Systeme an. Sie modellieren, analysieren und bewerten optische Abbildungssysteme auf der Basis der diskutierten Modellbeschreibungen für Abbildungsfehler. Auf der Basis der Kenntnis der Fehlerursachen lernen die Studierenden die ersten Grundzüge der Optimierung der Funktionalität optische Abbildungssysteme. In Vorlesungen und Übungen wird Fach-, Methoden- und Systemkompetenz vermittelt. Die Studierenden verfügen über Sozialkompetenz, die insbesondere durch intensive Förderung von Diskussion, Gruppen- und Teamarbeit vertieft wird.

Vorkenntnisse

Gute Mathematik und Physik Grundkenntnisse

Inhalt

Geometrisch-optische Abbildung und Abbildungsfehler, Analytische Bildfehlertheorie, Wellenoptische Theorie der Abbildung;

Medienformen

Daten-Projektion, Folien, Tafel Vorlesungsskript

Literatur

H. Gross, "Handbook of Optical Systems", Wiley VCH, Berlin. W. Richter: Bewertung optischer Systeme. Vorlesungsskript TU Ilmenau. H. Haferkorn: Optik. 4. Auflage, Wiley-VCH 2002. E. Hecht: Optik. Oldenbourg, 2001.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Maschinenbau 2009

Master Maschinenbau 2011

Master Maschinenbau 2014

Master Medientechnologie 2009

Master Medientechnologie 2013

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Master Optronik 2008

Modul: Bauelemente der Optik

Fertigungsverfahren optischer Bauelemente und Systeme

Fachabschluss: Prüfungsleistung schriftlich 90 min

Art der Notegebung: Gestufte Noten

Sprache: Deutsch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 7513

Prüfungsnummer: 2300123

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. Jean Pierre Bergmann

Leistungspunkte: 3

Workload (h): 90

Anteil Selbststudium (h): 68

SWS: 2.0

Fakultät für Maschinenbau

Fachgebiet: 2321

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				2	0	0															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Verständnis über die Herstellungsverfahren optischer Materialien und Bauelemente, ihre Bearbeitung und Oberflächenvergütung sowie über Technologien zum Fügen optischer Bauelemente, Erkennen der Zusammenhänge bei der Prozessauslegung und Qualitätssicherung

Vorkenntnisse

Grundlagen der Fertigungstechnik

Inhalt

Verfahren zur Bearbeitung und Strukturierung von optischem Glas, Kristallen und Kunststoffen, Prozessführung, Beeinflussung der optischen Oberflächenqualität, Verfahren zum Fügen optischer Bauelemente, Fertigung optischer Sonderbauelemente

Medienformen

Folien als PDF-File im Netz

Literatur

Horne, D.F.: Optical Production Technology. Bristol-Adam, Hilger Ltd., 1983 Kingslake, R.: Optical Systems Design. London/New York, Akademie Press, 1983 Yoder, P.R.: Opto-Mechanical Systems Design. New York/Basel Marcel Dekker, Inc., 1986 Grünwald, F.: Fertigungsverfahren der Gerätetechnik, Verlag Technik 1980

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Modul: Projektseminar

Modulnummer7464

Modulverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Gerhard Linß

Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert

Lernergebnisse

Lernziele des Projektseminars sind die Vermittlung von Forschungskompetenzen durch die Teilnahme der Studierenden an aktuellen Forschungsprojekten sowie die in der Industrie nachgefragten Soft-Skills wie Projektmanagement, Teamfähigkeit, Präsentationstechniken usw. Die Projektthemen weisen optronischen Charakter, d.h. Interdisziplinarität, auf. Das Projekt wird in Gruppenarbeit (3-8 Studenten in Abhängigkeit von der Komplexität der Aufgabe) durchgeführt und von einem Professor bzw. einem beauftragten Mitarbeiter betreut. Im Projektverlauf werden die wesentlichen Schritte der Entwicklung eines optronischen Systems von der Konzeption bis zur Realisierung durchlaufen. Der Arbeitsumfang jedes Studenten beträgt im ersten und im zweiten Mastersemester je 180 h, also insgesamt 360h. Ziel ist es ebenfalls, das Vermögen der Studierenden zu erhöhen, sich Wissen in Eigenarbeit anzueignen, sowie mit vorhandenen Werkzeugen und Anlagen, Software und Versuchsständen umzugehen.

Vorraussetzungen für die Teilnahme

Fächer des Bachelor-Studiums Optische Systemtechnik/Optronik

Detailangaben zum Abschluss

Das Vorhaben ist durch eine schriftliche Ausarbeitung nachzuweisen. Vorstellung der Ergebnisse bzw. der methodischen Vorgehensweise zur Ableitung wesentlicher Sachverhalte im Rahmen eine bis zu 30-minütigen Vortrages.

Projektseminar Optronik

Fachabschluss: Prüfungsleistung alternativ Art der Notengebung: Generierte Noten
 Sprache: Deutsch und Englisch Pflichtkennz.: Pflichtfach Turnus: unbekannt

Fachnummer: 8651 Prüfungsnummer: 90201

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Gerhard Linß

Leistungspunkte: 12	Workload (h): 360	Anteil Selbststudium (h): 360	SWS: 0.0
Fakultät für Maschinenbau			Fachgebiet: 2362

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	180 h			180 h																	

Lernergebnisse / Kompetenzen

Lernziele des Projektseminars sind die Vermittlung von Forschungskompetenzen durch die Teilnahme der Studierenden an aktuellen Forschungsprojekten sowie die in der Industrie nachgefragten Soft-Skills wie Projektmanagement, Teamfähigkeit, Präsentationstechniken usw. Die Projektthemen weisen optronischen Charakter, d.h. Interdisziplinarität, auf. Das Projekt wird in Gruppenarbeit (3-8 Studenten in Abhängigkeit von der Komplexität der Aufgabe) durchgeführt und von einem Professor bzw. einem beauftragten Mitarbeiter betreut. Im Projektverlauf werden die wesentlichen Schritte der Entwicklung eines optronischen Systems von der Konzeption bis zur Realisierung durchlaufen. Der Arbeitsumfang jedes Studenten beträgt im ersten und im zweiten Mastersemester je 180 h, also insgesamt 360h. Ziel ist es ebenfalls, das Vermögen der Studierenden zu erhöhen, sich Wissen in Eigenarbeit anzueignen, sowie mit vorhandenen Werkzeugen und Anlagen, Software und Versuchsständen umzugehen.

Vorkenntnisse

Inhalt

Im Projektverlauf werden die wesentlichen Schritte der Entwicklung eines optronischen Systems von der Konzeption bis zur Realisierung durchlaufen. Ziel ist es ebenfalls, das Vermögen der Studierenden zu erhöhen, sich Wissen in Eigenarbeit anzueignen, sowie mit vorhandenen Werkzeugen und Anlagen, Software und Versuchsständen umzugehen.

Medienformen

Literatur

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
- Master Optronik 2008
- Master Optronik 2010

Modul: Photonik

Modulnummer7516

Modulverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Siegfried Stapf

Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert

Lernergebnisse

Das Modul vermittelt theoretische und praktische Grundlagen des modernen Gebietes der Photonik. Die Studierenden sind in der Lage, moderne optoelektronische und photonische Bauelemente zu verstehen, zu entwerfen und anzuwenden.

Vorraussetzungen für die Teilnahme

abgeschlossenes Bachelorstudium in Optronik oder einem vergleichbaren naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Fach

Detailangaben zum Abschluss

Master Optronik 2008

Modul: Photonik

Laserphysik 1

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min

Art der Notengebung: Gestufte Noten

Sprache: Deutsch und Englisch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 7517

Prüfungsnummer: 2400203

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Gobsch

Leistungspunkte: 3

Workload (h): 90

Anteil Selbststudium (h): 68

SWS: 2.0

Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften

Fachgebiet: 2422

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	0	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studenten werden in das komplexe Gebiet der Laserphysik eingeführt. Dabei erlernen sie die physikalischen und optischen Grundlagen des Lasers, die Wirkungsweise und den Aufbau der verschiedenen Lasertypen sowie deren Einsatzfelder und deren Anwendung. Sie sind in der Lage, Laser und Laserbauelemente zu analysieren und zu bewerten sowie diese in optischen und photonischen Systemen gezielt zum Einsatz zu bringen.

Vorkenntnisse

Fundierte Grundkenntnisse der Optik, Atomphysik und Festkörper- und Halbleiterphysik

Inhalt

Eigenschaften des Laserlichtes; Strahlungsübergänge und Linienbreite; Laserprinzip; Laserresonatoren; Ausgewählte Lasersysteme; Beispiele für Laseranwendungen in verschiedenen Bereichen der Naturwissenschaft, Technik und Medizin; Lasersicherheit.

Medienformen

Tafel, Folien, Powerpoint, experimentelle Demonstrationen

Literatur

J. Eichler, H.J. Eichler, Laser - Grundlagen, Systeme, Anwendungen, Springer, Berlin; H. Fouckhardt, Photonik, Teubner, Stuttgart; B. E. A. Saleh, M. C. Teich - Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, New York; W. T. Silfvast, Laser Fundamentals, Cambridge University Press; R. S. Quimby, Photonics and Lasers - An Introduction, Wiley-Interscience

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optronik 2008

Molekülphysik und Spektroskopie

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min

Art der Notengebung: Gestufte Noten

Sprache: Deutsch und Englisch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 670

Prüfungsnummer: 2400206

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Siegfried Stapf

Leistungspunkte: 5

Workload (h): 150

Anteil Selbststudium (h): 105

SWS: 4.0

Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften

Fachgebiet: 2423

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	3	1	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Lehrveranstaltung vermittelt ein vertieftes Verständnis für den Aufbau der Moleküle sowie für die Wechselwirkung von Molekülen mit elektromagnetischen Wellen. Sie führt hin zu Makromolekülen und den molekularen Grundlagen der Polymerphysik. Schwerpunkte liegen auf den Spektroskopischen Methoden der Molekularen Analytik.

Vorkenntnisse

Module Experimentalphysik I und Experimentalphysik II sowie Chemie für Physiker

Inhalt

Molekülphysik, Wechselwirkung Licht und Materie, Molekülsymmetrie und ihr Einfluss auf die Spektroskopie, Gruppentheorie in der Molekülphysik, Rotations- und Schwingungsspektroskopie, Ramanspektroskopie, elektronische Absorption und Fluoreszenz, experimentelle Methoden der Spektroskopie, dopplerfreie Spektroskopie, Makromoleküle, funktionale Moleküle, Biomoleküle, molekulare Polymerphysik

Medienformen

Vorlesungen und Übungen, Folien, Beamer, Videos, Simulationen

Literatur

Demtröder: Laserspektroskopie Haken Wolf: Molekülphysik und Quantenchemie Bishop: Group Theory and Chemistry

Atkins: Physical Chemistry

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Bachelor Technische Physik 2008

Bachelor Technische Physik 2011

Bachelor Technische Physik 2013

LA BA Berufl. Schulen LA Berufliche Schulen - Erstfach Elektrotechnik 2008 Vertiefung PH

LA BA Berufl. Schulen LA Berufliche Schulen - Erstfach Metalltechnik 2008 Vertiefung PH

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Laserphysik 2

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch und Englisch Pflichtkennz.: Pflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 7518 Prüfungsnummer: 2400204

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Gobsch

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
 Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften Fachgebiet: 2422

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				1	1	0															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Lehrveranstaltung vermittelt die Grundlagen der Halbleiterphysik. Die Studierenden werden dadurch in die Lage versetzt, die elektronischen und optischen Eigenschaften von Halbleitern, deren Zusammenhang mit den Materialeigenschaften sowie deren Bedeutung für die Funktionsweise von Halbleiterbauelementen zu verstehen.

Vorkenntnisse

Experimentalphysik, Mathematik für Naturwissenschaftler und Ingenieure, Einführung in die Festkörperphysik, Atomphysik bzw. Quanten I (alle auf Bachelor-Niveau)

Inhalt

Vom Molekül zum Festkörper: Isolator–Halbleiter-Metall Quantenmechanisches Konzept - Einelektronen-Näherung Kristallgitter und reziprokes Gitter Kronig-Penney-Modell Allgemeine Beschreibung der Kristallelektronen (Blochfunktion, Bandstruktur) Bandstruktur einiger typischer Halbleiter Zustandsdichte Bänderschema Effektivmassen-Näherung - Enveloppenfunktion Störstellen Statistik der Elektronen und Löcher im Halbleiter Phononen Ladungsträgertransport Generation und Rekombination von Ladungsträgern

Medienformen

V: Folien, Beamer, Simulationen Ü: Wöchentliche Übungsseries Bereitstellung von Folien (Grafiken, Diagramme etc) zur Vorlesung sowie englischsprachige Zusammenfassungen zu jeder Vorlesung

Literatur

C. Kittel: Einführung in die Festkörperphysik, Oldenburg 2002 H. T. Grahn: Introduction to Semiconductor Physics, World Sc., P.Y.Yu, M.Cardona: Fundamentals of Semiconductors: Physics and Materials Properties J. Singleton: Band Theory and Electronic Properties of Solids, Oxford 2001

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optronik 2008

Master Optronik 2008
Modul: Photonik

Lichtstreuung und Partikelmesstechnik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notegebung: Gestufte Noten
Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Pflichtfach Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 684 Prüfungsnummer: 2400205

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Siegfried Stapf

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften Fachgebiet: 2423

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				1	1	0															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Fachkompetenz: 70%

Vorkenntnisse

Vordiplom Physik; Vorlesung Spektroskopie und Umweltanalytik

Inhalt

Wechselwirkung Licht und Materie, elastische und ineleastische Lichtstreuung, Rayleigh- Streuung, Mie Streuung, Lichtstreuung nichtsphärischer Partikel, optische Partikelmesstechnik Ramanstreuung und ihre Anwendung in der Partikelmeßtechnik

Medienformen

Tafel und Kreide, Overheadfolien, selbst geschriebene Lehrprogramme per Beamer

Literatur

Bohren Huffman: Absorption and Scattering of Light by Small Particles Albrecht, Borys, Damaschke, Tropea: Laser Doppler and Phase Doppler Measurement Techniques McCreery: Raman Spectroscopy for Chemical Analysis

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optronik 2008

Master Optronik 2008

Modul: Photonik

Ultramikroskopie

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min

Art der Notegebung: Gestufte Noten

Sprache: keine Angabe

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 7519

Prüfungsnummer: 2400207

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Siegfried Stapf

Leistungspunkte: 4

Workload (h): 120

Anteil Selbststudium (h): 98

SWS: 2.0

Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften

Fachgebiet: 2423

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				1	0	1															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Vorkenntnisse

Inhalt

Medienformen

Literatur

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optronik 2008

Modul: Optotechnik

Modulnummer7520

Modulverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Gerhard Linß

Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert

Lernergebnisse

Die Studierenden verfügen über vertieftes Wissen über Herstellung, Aufbau und Anwendung der gesamten Breite optischer Geräte. Sie sind fähig komplexe mess- und erkenntnisstechnische Aufgaben der digitalen Bildverarbeitung zu lösen. Sie haben vertieftes Wissen über die speziellen Werkstoffe der Optik und sind in der Lage Aufgaben der Justierung zu bearbeiten. Sie verfügen über ausgeprägte Kenntnisse des Aufbaus mechanisch-optischer Funktionsgruppen und können Aufgaben zu deren Entwicklung, Herstellung und Anwendung selbständig übernehmen.

Vorraussetzungen für die Teilnahme

Fächer des Bachelor-Studiums Optische Systemtechnik/Optronik

Detailangaben zum Abschluss

Herstellung optischer Werkstoffe

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Pflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 386 Prüfungsnummer: 2300125

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Edda Rädlein

Leistungspunkte: 4 Workload (h): 120 Anteil Selbststudium (h): 86 SWS: 3.0
 Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2351

SWS nach Fachsemester	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	0	1																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Praktische Erfahrung in der Beurteilung der Qualität von optischen Werkstoffen, Oberflächen und Schichten. Vertieftes Verständnis moderner Produktionsprozesse. Naturwissenschaftliche Grundlagen für die Werkstoffentwicklung in neuen optischen Anwendungen. Kenntnis von ausgewählten aktuellen Forschungsergebnissen und die Fähigkeit, Entwicklungstrends zu beurteilen.

Vorkenntnisse

Fertigungstechnik und Werkstoffe aus dem Grundstudium, Fertigungsverfahren und Werkstoffe der Optik aus dem 4. Semester

Inhalt

Spezielle Methoden der Herstellung optischer Bauelemente.
 Qualität optischer Bauelemente im Hinblick auf Homogenität, Transmission, Brechzahl und Oberflächenbeschaffenheit.
 Werkstoffe aus Glas, Keramik, Einkristallen und transparenten Polymeren, deren Bearbeitung und Anwendungen (zum Beispiel in der Solartechnik, in der Mikrofertigung, für schaltbare Transmission).

Medienformen

Tafelbild, Anschauungsmuster, PowerPoint, Skript

Literatur

für einzelne Kapitel:
 H. Bach und N. Neuroth, hrsg., The Properties of Optical Glass, Schott Series on Glass and Glass Ceramics, Springer, Berlin (1998)
 J. Bliedtner und G. Gräfe, Optiktechnologien, Hanser Fachbuchverlag, Leipzig 2008
 D. Hülsenberg, A. Harnisch und A. Bismarck, Microstructuring of Glasses, Springer Series in Materials Science, Springer, Berlin etc. 2008

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
 Master Optronik 2008

Justierung

Fachabschluss: Prüfungsleistung generiert
Sprache: Deutsch

Art der Notegebung: Generierte Noten
Pflichtkennz.: Pflichtfach Turnus: ganzjährig

Fachnummer: 280

Prüfungsnummer: 230128

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christian Weber

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2312

SWS nach Fachsemester	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	1	1	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

0,7

Vorkenntnisse

Grundlagen der Konstruktion Konstruktionsmethodik/CAD

Inhalt

Fehler an technischen Produkten (Erscheinungsformen, Einteilung); Fehlerkritik (Ablauf, mathematische Hilfsmittel); Fehler- und Justiergleichung (Methoden der maximalen Abweichung/ statistische Summe, Innozenz, Invarianz, Prinzip der Fehlerminimierung); Toleranzen (Toleranzketten, Übertolerierung, Toleranzsynthese) Justierkreis/ Justiermethoden/ Justiermittel

Medienformen

Lehrblätter, Vorlesungsskripte,

Literatur

Krause, W.: Gerätekonstruktion in Feinwerktechnik und Elektronik. Hanser-Verlag, München 2000 Hansen, F. : Justierung. Verlag Technik Berlin 1967

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Maschinenbau 2009

Master Maschinenbau 2011

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Master Wirtschaftsingenieurwesen 2009

Master Wirtschaftsingenieurwesen 2009 Vertiefung MB

Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010

Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010 Vertiefung MB

Master Wirtschaftsingenieurwesen 2011 Vertiefung MB

Master Optronik 2008
Modul: Optotechnik

Mechanisch-optische Funktionsgruppen 1

Fachabschluss: Prüfungsleistung generiert

Art der Notegebung: Generierte Noten

Sprache: Deutsch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 5959

Prüfungsnummer: 230130

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rene Theska

Leistungspunkte: 4	Workload (h): 120	Anteil Selbststudium (h): 86	SWS: 3.0
Fakultät für Maschinenbau			Fachgebiet: 2363

SWS nach Fachsemester	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	1	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage, konstruktive Probleme für die Entwicklung mechanisch-optischer Baugruppen in Geräten selbstständig zu lösen. Sie werden in die Lage versetzt, erworbenes Wissen auf dem Gebiet der Optik und Feinwerktechnik konstruktiv umzusetzen.

Vorkenntnisse

Bachelor-Abschluß in einem natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Fach Grundkenntnisse in geometrischer Optik

Inhalt

Spiegel, Spiegelsysteme und Spiegelprismen Objektive Zusammengesetzte Systeme Unschädliche Kippachsen Instrumente der Fluchtungs- und Richtungsprüfung Innozente und invariante Anordnungen

Medienformen

Folien, Tafelbild, Anschauungsobjekte, Arbeitsblätter

Literatur

H. Haferkorn, Optik: physikalisch-technische Grundlagen und Anwendungen, 4., bearb. und erw. Aufl., Weinheim, Wiley-VCH, 2003. A. König und H. Köhler, Die Fernrohre und Entfernungsmesser, 3., völlig neu bearb. Aufl., Berlin [u.a.], Springer, 1959.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Bachelor Maschinenbau 2013
- Master Maschinenbau 2009
- Master Maschinenbau 2011
- Master Maschinenbau 2014
- Master Mikro- und Nanotechnologien 2008
- Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013 Vertiefung MB

Digitale Bildverarbeitung 2

Fachabschluss: Prüfungsleistung schriftlich 90 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Pflichtfach Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 7410 Prüfungsnummer: 2300124

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Gerhard Linß

Leistungspunkte: 4 Workload (h): 120 Anteil Selbststudium (h): 86 SWS: 3.0
 Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2362

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				2	0	1															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden verfügen über die Fähigkeit komplexe messtechnische Aufgaben mit Bildverarbeitung zu lösen. Sie verfügen über Kenntnisse der Subpixelantastung zur berührungslosen ein- und zweidimensionalen Messung. Die Studierenden sind in Lage Messanordnungen zur berührungslosen dreidimensionalen Messung zu berechnen und zu entwerfen. Die Studenten sind in der Lage Verfahren die automatisierte optische Prüfung und Qualitätssicherung von Komponenten und Baugruppen im Makro-, Mikro- und Nanometerbereich zu analysieren.

Sie verfügen über Kenntnisse zu den Grundlagen der Farbbildverarbeitung. Sie sind in der Lage Farbräume zu transformieren und Aufgaben der Farb- und Farb-Orts-Bestimmung zu lösen.

Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Merkmalsidentifikation und Mustererkennung im Grau- und Farbbild. Sind in der Lage Klassifikationsverfahren auf der Grundlage von Geometrie, Farb- und Texturmerkmalen wie Fläche, Umfang, Schwerpunkt, Momente, Krümmung, Oberflächenfarbe und Oberflächenbeschaffenheit anzuwenden. Sie sind fähig Lösungen auf der Grundlage von Nächsten-Nachbar-Klassifikatoren, Template Matching und neuronalen Netze zu entwerfen.

Im zugehörigen Praktikum werden die in der Vorlesung erworbenen Kenntnisse in vier Versuchen zur zweidimensionalen Präzisionsmessung, zur dreidimensionalen Messung, zur Farbklassifikation und zur Oberflächeninspektion vertieft.

Vorkenntnisse

Naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Fächer des Gemeinsamen Ingenieurwissenschaftlichen Grundstudiums

Inhalt

1. Messverfahren Eindimensional
2. Messverfahren Zweidimensional
3. Messverfahren Dreidimensional
3. Messverfahren im Mikrobereich
5. Farbbildverarbeitung Grundlagen
6. Automatisierte Klassifikation mit Methoden des maschinellen Lernens

Medienformen

Beamer, Tafel, Live-Vorführung von Algorithmen

Literatur

- [1] Brückner, Peter; Correns, Martin; Anding, Katharina: Vorlesungsskript Digitale Bildverarbeitung 2, TU Ilmenau 2012
 [2] Ernst, H. ; Einführung in die digitale Bildverarbeitung; Franzis Verlag, München 1991

[3] Jähne, B. ; Digitale Bildverarbeitung 2.Aufl. ; Springer Verlag Berlin, Heidelberg 1991

[4] Gonzalez, Rafael C.; Woods, Richard E.: Digital Image Processing; Third Edition; Pearson Prentice Hall, New Jersey 2008

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Mechatronik 2008

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Master Optronik 2008
Modul: Optotechnik

Mechanisch-optische Funktionsgruppen 2

Fachabschluss: Prüfungsleistung generiert

Art der Notengebung: Generierte Noten

Sprache: Deutsch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: unbekannt

Fachnummer: 7469

Prüfungsnummer: 230132

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rene Theska

Leistungspunkte: 3	Workload (h): 90	Anteil Selbststudium (h): 68	SWS: 2.0
Fakultät für Maschinenbau			Fachgebiet: 2363

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				1	1	0															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage, konstruktive Probleme für die Entwicklung mechanisch-optischer Baugruppen in Geräten selbstständig zu lösen. Sie werden in die Lage versetzt, erworbenes Wissen auf dem Gebiet der Optik und Feinwerktechnik konstruktiv umzusetzen und optische Messgeräte fachgerecht anzuwenden.

Vorkenntnisse

Bachelor-Abschluß in einem natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Fach Grundkenntnisse in geometrischer Optik; Mechanisch-optische Funktionsgruppen 1

Inhalt

Optische Mess- und Prüfmittel Entfernungsmesser Beleuchtungen

Medienformen

Folien, Tafelbild, Anschauungsobjekte, Arbeitsblätter

Literatur

H. Haferkorn, Optik: physikalisch-technische Grundlagen und Anwendungen, 4., bearb. und erw. Aufl., Weinheim, Wiley-VCH, 2003. A. König und H. Köhler, Die Fernrohre und Entfernungsmesser, 3., völlig neu bearb. Aufl., Berlin [u.a.], Springer, 1959.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Maschinenbau 2009
- Master Maschinenbau 2011
- Master Maschinenbau 2014
- Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
- Master Optronik 2008
- Master Optronik 2010

Modul: Optische Sensor- und Informationstechnik

Modulnummer7523

Modulverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Ivo Rangelow

Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert

Lernergebnisse

Die Studierenden sind fähig komplexe Aufgaben der Übertragung und Speicherung von Informationen auf optischer und optoelektronischer Grundlage zu lösen und besitzen vertieftes Wissen über die Anwendung der Mikro- und Nanotechnologie für die Optoelektronik. Die Studierenden verfügen über umfangreiches Wissen über Herstellung, Aufbau und Anwendung der gesamten Breite optischer Sensoren. Sie verfügen über ausgeprägte Kenntnisse auf dem Gebiet der optischen Telekommunikationstechnik. Die Studenten sind in der Lage die Technologie der Photovoltaik und Energiewandlung für komplexe technische Lösungen auf dem Gebiet der Energieversorgung anzuwenden.

Vorraussetzungen für die Teilnahme

Abschluss der Lehrveranstaltungen des gemeinsamen ingenieurwissenschaftlichen Studiums. Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitsrechnung, ausgewählte Methoden der Algebra, Grundlagen der Elektronik, Optische Telekommunikationstechnik, Technologie optoelektronischer Bauelemente.

Detailangaben zum Abschluss

Master Optronik 2008

Modul: Optische Sensor- und Informationstechnik

Optische Sensoren und Empfänger

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min

Art der Notengebung: Gestufte Noten

Sprache: Deutsch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 7525

Prüfungsnummer: 2100154

Fachverantwortlich: PD Dr.-Ing. habil. Susanne Scheinert

Leistungspunkte: 4	Workload (h): 120	Anteil Selbststudium (h): 98	SWS: 2.0
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik			Fachgebiet: 2141

SWS nach Fachsemester	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	0	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studenten erhalten einen Überblick über die Grundlagen optischer Sensoren und Empfänger sowie über aktuelle Entwicklung auf diesem Gebiet. Sie werden mit den physikalischen Grundlagen der Optoelektronik (Schwerpunkt Sensoren und Empfänger, Wechselwirkung Strahlung – Halbleiter, Wechselwirkung Elektron-Photon) vertraut gemacht und erhalten Kenntnisse zu den für die Optoelektronik relevanten Materialaspekten. Die Studenten lernen wichtige Sensor-, Empfänger- und Detektorbauelemente und deren Aufbau kennen. Sie sind in der Lage, die Funktionsweise dieser Bauelemente zu verstehen. Sie erhalten eine Einführung in die wichtigsten Anwendungen der behandelten Bauelemente und über die Grundstruktur optischer Übertragungssysteme. Darüber hinaus sind sie fähig, zukünftige Trends in der Optoelektronik, speziell auf dem Gebiet der Empfänger optischer Übertragungssysteme, kritisch zu bewerten.

Vorkenntnisse

Grundlagenvorlesungen Elektronik, Physik, Mathematik

Inhalt

1. Physikalische Grundlagen 2. Materialaspekte 3. Optische Sensor- und Empfängerbauelemente - Photoleiter - Photodioden - Phototransistoren - Solarzellen - Image-Detektoren 4. Optische Übertragungssysteme 5. Trends

Medienformen

PowerPoint-Präsentationen, Tafel, kompletter Satz der Folien aus der Vorlesung als PDF

Literatur

1. R. Paul, Optische Halbleiterbauelemente, Teubner 1992. 2. W. B. Leigh, Devices for Optoelectronics, Marcel Dekker 1996. 3. E. Uiga, Optoelectronics, Prentice-Hall 1995. 4. K. F. Brennan, The Physics of Semiconductors: With Applications to Optoelectronic Devices, Cambridge University Press 1999.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Master Optronik 2008

Modul: Optische Sensor- und Informationstechnik

Photovoltaik und Energiewandlung

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min

Art der Notegebung: Gestufte Noten

Sprache: Deutsch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 7526

Prüfungsnummer: 2100155

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Petzoldt

Leistungspunkte: 4

Workload (h): 120

Anteil Selbststudium (h): 86

SWS: 3.0

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Fachgebiet: 2161

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	1	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studenten erhalten eine Zusammenfassung der grundlegenden Eigenschaften von Solargeneratoren und deren mögliche Verschaltung. Die optimale Energieübertragung von der Solarzelle über einen DC-Bus bis zum Wechselspannungsnetz wird behandelt. Die Studenten können die verschiedenen schaltungstechnischen Möglichkeiten bewerten und gezielt auf den aktuelle Aufgabenstellung anwenden. Sie sind nur in der Lage Solaranlagen zu projektieren, sondern auch Schaltungstopologien sowie Steuer- und Regelverfahren gezielt auszuwählen, diese umzusetzen sowie leistungselektronische Komponenten und Baugruppen zu projektieren und zu entwickeln. Sie sind befähigt, Simulationen und Messungen an Solarsystemen durchzuführen, diese auszuwerten und Schlussfolgerungen zu ziehen.

Vorkenntnisse

Hochschulreife

Inhalt

Eigenschaften und Kennlinien von Solarmodulen Aufbau von Solarfeldern Konzeptionen zur optimalen Energieabnahme aus den Solarzellen Leistungselektronische Schaltungsvarianten zur Leistungserhöhung durch Parallelschaltung Steuerungs- und Regelungsvarianten für das Management der Teilleistungen Maximum-Power-Point (MPP) Regelung Leistungselektronische Komponenten von Photovoltaikanlagen (DC/DC-Wandler, Laderegler, Wechselrichter, Speicher) Betriebsführung der Wechselrichtereinheiten (Redundanz, Power-Sharing, Netzsynchronisation, Netzausfallerkennung) Gewährleistung der erforderlichen Energiequalität Bildung von Inselnetzen, Regelverfahren für den stabilen Betrieb von Inselnetzen

Medienformen

Vorlesung mit Tafelbild, gedruckte Vorlesungsblätter

Literatur

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Mikro- und Nanotechnologien für die Optoelektronik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min

Art der Notengebung: Gestufte Noten

Sprache: Deutsch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 7524

Prüfungsnummer: 2100153

Fachverantwortlich: Dr. rer. nat. Jörg Pezoldt

Leistungspunkte: 3

Workload (h): 90

Anteil Selbststudium (h): 68

SWS: 2.0

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Fachgebiet: 2142

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				2	0	0															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Aufbauend auf der Vorlesung „Technologie optoelektronischer Bauelemente“ werden weiterführende Techniken behandelt, die für die Realisierung von Bauelementen der Optoelektronik notwendig, welche auf lateral und vertikal strukturierte Gebiete im Nanometerbereich beruhen. In der Lehrveranstaltung werden ausgehend vom Design der Bauelemente die technologischen Verfahren für ihre Herstellung abgeleitet und im einzelnen behandelt. Neben den deterministischen Strukturierungs- und Prozessierungsprinzipien werden Technologien vermittelt, die auf Selbstformierungs- und Selbstorganisationsprinzipien beruhen. Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse über die Herstellung nanooptoelektronischer Bauelemente und sind fähig technische und wirtschaftliche Aspekte zu beurteilen. Sie sind in der Lage Prozeßabläufe für die Herstellung nanooptoelektronischer Bauelemente und Systeme zu analysieren und zu entwickeln. Sie sind fähig zur Systemintegration optoelektronischer Bauelemente unter Einbeziehung von Spiegeln und Wellenleitern

Vorkenntnisse

Die Vorlesung baut auf der Vorlesung „Technologie optoelektronischer Bauelemente“ des BA Optronik. Es werden gleichzeitig Kenntnisse auf dem Gebiet der Wirkungsweise von optischen Sensoren und Empfängern, Feskörperlaser, Solarzellen und nanooptischen Komponenten vorausgesetzt.

Inhalt

1. Nanooptoelektronische Bauelemente 2. Deterministische und selbstorganisierende Technologien 3. Prinzipien der Selbstorganisation und Selbstformierung in technologischen Prozessen 4. Nanolithographie 5. Nanoätzen 6. Nanoepitaxie 7. Nanoionenimplantation

Medienformen

Overhead-Folien und Tafel

Literatur

1. H. Zimmermann, Silicon optoelectronic integrated circuits, Springer, 2004, 352 S. 2. Optical Interconnects: The Silicon Approach, Eds. L. Pavesi, G. Guillot, Springer, 2006, 377 S. 3. Z. Cui, Nanofabrication: Principles, Capabilities and Limits, Springer, 2009, 348 S. 4. V.A. Shuchkin, N.N. Ledentsov, D. Bimberg, Epitaxy of Nanostructures, Springer, 2003, 387 S. 5. S. Janusonis, Self-formation Theory and Applications, Solid State Phenomena, Vol. Vols. 97-98, 2004, 492 S.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Optische Telekommunikationstechnik 2

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min

Art der Notengebung: Gestufte Noten

Sprache: Deutsch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 5191

Prüfungsnummer: 2100152

Fachverantwortlich: Dr.-Ing. Mike Wolf

Leistungspunkte: 3

Workload (h): 90

Anteil Selbststudium (h): 68

SWS: 2.0

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Fachgebiet: 2111

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS					
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				2	0	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

In der Vorlesung "Optische Telekommunikationstechnik 2" stehen die nachrichtentechnischen Aspekte der optischen Übertragung auf der Basis von Lichtwellenleitern im Vordergrund. Die Studenten werden in die Lage versetzt, moderne optische Übertragungssysteme bzw. Teile solcher Systeme zu modellieren, zu analysieren und zu entwerfen. Einen Schwerpunkt bilden dabei Modulationsverfahren, die sich für die Übertragung auf der Basis von WDM (Wavelength-Division Multiplex) eignen. Dabei lernen die Studenten einerseits Möglichkeiten zur Erzeugung und zum Empfang der entsprechenden Signale kennen. Andererseits werden die Hörer befähigt, ausgewählte Verfahren im Zusammenhang mit den Hauptproblemen der Übertragung (wie optisches Verstärkerrauschen, Dispersion oder WDM-Nebensprechen) zu betrachten und zu analysieren. Die physikalische Beschreibung der Komponenten (vermittelt in "Optische Telekommunikationstechnik 1") wird dabei zunehmend abstrahiert, so dass die Studenten zu einer systemtheoretischen Modellierung gelangen. Die Studenten können inkohärent arbeitende Detektoren von kohärenten Alternativen abgrenzen und werden befähigt, das elektrische Empfangsfrontend zu entwerfen und dessen Empfindlichkeit zu evaluieren. Sie verstehen wesentliche Techniken des Dispersionsmanagements und kennen den Aufbau optischer Netzwerke.

Vorkenntnisse

Optische Telekommunikationstechnik 1, Kenntnisse der Informationstechnik und Systemtheorie aus Lehrveranstaltungen des gemeinsamen ingenieurwissenschaftlichen Grundstudiums und des 5. Semesters

Inhalt

1 Bestandsaufnahme 2 Kohärenter und inkohärenter Empfang 3 Modulation und Codierung 4 Additive Störungen und Empfängeranalyse 5 Lineare Verzerrungen und Dispersionsmanagement 6 Nichtlineare Verzerrungen 7 WDM-Systeme 8 Optische Netzwerke

Medienformen

Tafelentwicklung, Präsentation von Begleitfolien über Videoprojektor, Folienscript im Copy-Shop und online erhältlich, Literaturliste und Liste mit Prüfungsfragen online

Literatur

J. G. Proakis and M. Salehi, "Grundlagen der Kommunikationstechnik," Pearson Studium, 2004. K. Kammeyer, "Nachrichtenübertragung," Teubner Verlag, 3 ed., 2004. G. Agrawal, "Lightwave Technology: Telecommunication Systems," John Wiley & Sons, Inc., 2005. W. Glaser, "Photonik für Ingenieure," Verlag Technik Berlin, 1997. D. Eberlein, "Lichtwellenleitertechnik," expert verlag, 6 ed., 2006. D. Eberlein, "DWDM: Dichtes Wellenlängenmultiplex," Dr. M. Siebert GmbH, 2003. P. Winzer and R. Essiambre, "Advanced Optical Modulation Formats," Proceedings of the IEEE, vol. 94, pp.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Informationstheorie und Codierung

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min

Art der Notengebung: Gestufte Noten

Sprache: Deutsch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 1378

Prüfungsnummer: 2100022

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Jochen Seitz

Leistungspunkte: 4

Workload (h): 120

Anteil Selbststudium (h): 86

SWS: 3.0

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Fachgebiet: 2114

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				2	1	0															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden kennen informationstheoretische Beschreibung und Kenngrößen der Quellenmodelle, des Übertragungskanal, von Leitungscodierungen. Sie Verstehen Optimalcodierungen, Fehlerkorrigierende Codierungsverfahren, Grundlagen der Chiffrierung, Anwendungen der Codierungstheorie in orthogonalen Multiplexverfahren und Kombination von Optimalcodierung und Modulation. Die Studierenden sind in der Lage, Codes hinsichtlich Redundanz, Störsicherheit und Chiffrierung zu bewerten und zu synthetisieren. Sie können die Effizienz der Redundanzreduktion für bekannte Standardverfahren in modernen Informationsübertragungssystemen (leitungsgelassen und drahtlos) analysieren und grundlegende Verfahren der Optimalcodierung in Anwendungen synthetisieren. Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, neue Verfahren der Codierungstechnik zu verstehen, zu bewerten und zu synthetisieren.

Vorkenntnisse

Pflichtfächer in den Semestern 1-4, Wahrscheinlichkeitsrechnung, ausgewählte Methoden der Algebra

Inhalt

- Nachrichtenübertragungsmodell, Signalquellen, informationstheoretische Beschreibung, Entropie.
- Quellencodierung, Redundanzminderung nach Fano und Huffman, Codierung von Markoff-Prozessen.
- Redundanzminderung durch Transformation, Selektion und Quantisierung
- Übertragungskanal, informationstheoretische Beschreibung, Signal/Rausch-Verhältnis und Fehlerwahrscheinlichkeit
- Informationstheoretische Modellierung des Übertragungskanal, Informationsfluss und Kanalkapazität
- Leitungscodierungen (AMI, HDB3, PST, 4B3T, 5B6B, CMI, 8B6T)
- Fehlerkorrigierende Codierung (Kanalcodierung), Grundlagen, Fehlererkennung, Fehlerkorrektur, Restfehlerrate
- Hamming-Codes, Linearcodes, zyklische Codes, Technische Realisierung
- Burstfehlerkorrektur. Faltungscodierung und Viterbi- Algorithmus
- Galoisfeld, BCH-Codes, RS-Codes. Turbo codes.
- Chiffrierung (DES, RSA), Digitale Signaturen, symmetrische u. asymmetrische Verfahren
- Orthogonalcodes und CDMA
- Trellis-Codierte Modulation (TCM).

Medienformen

Folienpräsentation Übungsscript Tafelanschrieb Folienscript bei Copy-Shop erhältlich Literaturverweise und Liste mit Prüfungsfragen online

Literatur

Rohling, H.: 'Einführung in die Informations- und Codierungstheorie', Teubner-Verlag 1995, ISBN 3-519-06174-0 Bossert, M.: 'Kanalcodierung' Teubner-Verlag 1998, ISBN 3-519-06143-0 Kubas, Chr.: 'Informations- und Kodierungstheorie' 4. Lb, Dresden 1991, ISBN 02-1590-04-0 Klimant, H.; Piotraschke,R.; Schönfeld,D.: 'Informations- und Kodierungstheorie', Teubner-Verlag 2006, ISBN 3-8154-2300-7 Strutz,T.: 'Bildratenkompression', Vieweg-Verlag 2005, ISBN 3-528-13922-6 Finger, A.: 'Digitale Signalstrukturen in der Informationstechnik' VEB Verlag Technik 1985 Wobst, R.: 'Abenteuer Kryptologie', Addison-Wesley 2001, ISBN 3-8273-1815-7 Fey,P.: 'Informationstheorie', Akademie-Verlag Berlin 1963 Vaupel,Th.: 'Ein Beitrag zur Transformationscodierung von Audiosignalen' (Diss.) Valenti,M. C.: 'Iterative Detection and Decoding for Wireless Communications', Dissertation 1999, Blacksburg, Virginia Golomb,S.W.: 'Run-length-Encodings', IEEE Trans. on information theory, vol.12, Sept. 1966, pp.399-401

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2008
- Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013
- Master Ingenieurinformatik 2009
- Master Ingenieurinformatik 2013
- Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
- Master Optronik 2008
- Master Optronik 2010

Modul: Wahlfächer

Modulnummer7527

Modulverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Gerhard Linß

Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert

Lernergebnisse

Den Studierenden soll die Möglichkeit eröffnet werden, sich auf dem, Ihrer gewählten Studienrichtung entsprechenden, technischen Wissensgebieten zu vertiefen.

Darüber hinaus besteht aber auch die Möglichkeit die Basis des Fachwissens durch die Wahl von weiteren interessierenden Fächern zu erweitern.

Der Fächerkatalog enthält die Zusammenstellung der Wahlfächer für alle drei Vertiefungsrichtungen. Der Katalog wird jährlich durch die Studiengangkommission Optronik bewertet und aktualisiert

Vorraussetzungen für die Teilnahme

Fächer des Bachelor-Studiums Optische Systemtechnik/Optronik

Detailangaben zum Abschluss

2D-Systemtheorie

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min

Art der Notengebung: Gestufte Noten

Sprache: Deutsch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 5585

Prüfungsnummer: 2100145

Fachverantwortlich: Prof. Dr.-Ing. habil. Franz Schmidt

Leistungspunkte: 5	Workload (h): 150	Anteil Selbststudium (h): 105	SWS: 2.0
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik			Fachgebiet: 2116

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	0	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage die grundlegenden Prinzipien und Anforderungen der 2-D-Systemtheorie für Bilddatenerfassungs Kanäle zu bewerten und anzuwenden, sie sind mit der Theorie vertraut und in der Lage, praktische Aufgaben selbständig zu lösen. Sie können selbständig Effekte und Phänomene bei der Bilddatenerfassung und Übertragung bewerten und den verschiedenen Komponenten im Kanal zuordnen. Mit diesen Erkenntnissen können sie Bilddatenerfassungssysteme einschätzen und Vorschläge zu ihrer Optimierung erarbeiten.

Vorkenntnisse

Abgeschlossenes Grundstudium der Elektrotechnik, Informatik, Ingenieurinformatik oder Maschinenbau

Inhalt

Mathematische Grundlagen Abtastung von Bildern (Abtasttheorem, Abtastgitter, Scannen) Umwandlung des 2-D-Bildsignals in das 1-D-Videosignal (Zusammenhang zwischen 2-D-Bildspektrum und 1-D-Videosignalspektrum, Beispiele) Signalstatistik, Rauschen (grundsätzliche Bemerkungen, Rauschquellen in Bilddatenaufnahmesystemen) Bildübertragungskanal (SampleSchaltung, Analog-Digital-Umsetzer) Übergang von der Analog- zur Digitalkamera Bestimmung von CCD- und CCD-Kamera-Eigenschaften (Dunkelsignaleigenschaften, Hellsignaleigenschaften) Übertragungseigenschaften optischer u.a. Abbildungssysteme (Bewertungsfunktionen, Übertragungsverhalten eines beugungsbegrenzten optischen Systems, Röntgenabbildung, Tomografieverfahren) Informationsübertragung durch reale Abbildungssysteme unter realen Beleuchtungssituationen (Beleuchtung, Abbildung) Möglichkeiten der 2-D-Datengewinnung

Medienformen

Vorlesungsskript

Literatur

Vorlesungsskript

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 Vertiefung ATE

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Fertigungs- und Lasermesstechnik 2

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 5556 Prüfungsnummer: 2300108

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Eberhard Manske

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
 Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2373

SWS nach Fachsemester	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	0	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden überblicken die Messprinzipien, Messverfahren und Messgeräte der Längen- und Winkelmesstechnik, Fluchtungs- und Richtungsmessung, das Gebiet der Laserinterferometrischen Messverfahren und die Oberflächenmesstechnik hinsichtlich Aufbau, Funktion und Eigenschaften der Geräte und Verfahren, mathematischer Beschreibung als Grundlage der Messunsicherheitsanalyse, Anwendungsbereiche und Kosten. Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen die eingesetzten Prinzipien erkennen und entsprechend bewerten. Die Studierenden sind fähig, entsprechende Messaufgaben in der Fertigungstechnik zu analysieren, geeignete, insbesondere moderne laserbasierte Messverfahren zur Lösung der Messaufgaben auszuwählen und anhand des Unsicherheitsbudgets die messtechnischen Eigenschaften zu bewerten, um schließlich einen geeigneten Geräteentwurf vorzulegen. Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen.

Vorkenntnisse

Messtechnische Kenntnisse aus den Lehrveranstaltungen "Prozessmess- und Sensortechnik 1 und 2" und "Fertigungs- und Lasermesstechnik 1" aus dem Bachelor EIT

Inhalt

Laserinterferometrische Messverfahren: Systemkomponenten; Natur des Lichtes; Interferenz von Lichtwellen; Homodyn- und Heterodynverfahren; Wellenfrontteilung; Amplitudenteilung; Messtechnische Leistungsfähigkeit der Interferometer (Auflösungsvermögen, Genauigkeit); Wellenlängenkorrektur (Edlen-Formel); Kohärenz (zeitliche und räumliche); Aufbau, Wirkungsweise, Stabilisierung und messtechnische Eigenschaften von He-Ne-Lasern und Laserdioden; Komponenten und Geräte (optische Bauelemente, Laserinterferometer) Grundlagen und Geräte der Oberflächenmesstechnik: Gestaltabweichungen 1. bis 6. Ordnung; winklige Oberfläche; geometrische Oberfläche; Schnitte; Profile; Bezugsliniensysteme; Senkrechtkenngößen; Waagrechtkenngößen; Formprüfgeräte; mechanische Tastschnittverfahren; optische Tastschnittverfahren (Autofokus, Lichtschnittverfahren, interferometrische Verfahren); Rastersondenverfahren (STM, AFM); Nanopositionier- und Nanomessverfahren

Medienformen

Tafel und Kreide, Nutzung der Möglichkeiten von Laptop mit Präsentationssoftware oder Overheadprojektor mit Folien je nach Raumausstattung. Für die Studierenden werden Lehrmaterialien bereitgestellt. Sie bestehen u.a. aus kapitelweise nummerierten Arbeitsblättern mit Erläuterungen und Definitionen sowie Skizzen der Meßprinzipien und –geräte, deren Inhalt mit der Präsentation / den Folien identisch ist.

Literatur

Das Lehrmaterial enthält ein aktuelles Literaturverzeichnis. 1. Tilo Pfeifer. Fertigungsmeßtechnik. Oldenbourg 2001. ISBN 3-486-25712-9, ISBN 3-486-24219-9 2. Wolfgang Dutschke. Fertigungsmeßtechnik. Teubner 2002. ISBN 3-519-36322-4, ISBN 3-519-46322-9

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 Vertiefung AST

Master Maschinenbau 2009

Master Maschinenbau 2011

Master Maschinenbau 2014

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013 Vertiefung MB

Festkörperlaser und Verstärker

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 7537 Prüfungsnummer: 2100151

Fachverantwortlich: Univ.-Prof Dr. Heiko Jacobs

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Fachgebiet: 2142

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	0	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Aufbauend auf der Vorlesung „Mikro- und Nanotechnologien für die Optoelektronik“ werden die physikalischen Grundlagen, die Wirkprinzipien und Komponenten von Festkörperlaser und Verstärkern behandelt. Dabei wird der Materialauswahl und dem strukturellen Design der Festkörperlaser und Verstärker für die Erzeugung gewünschter Wellenlänge besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das vermittelte vertiefende theoretische und praktische Wissen versetzt den Studierenden in die Lage Festkörperlaser und Verstärker zu bewerten und zu analysieren. Sie werden in die Lage versetzt eigenständig solche Bauelemente zu entwerfen, herzustellen, sowie Beiträge zur Entwicklung neuartiger Festkörperlaser und Verstärker zu leisten.

Vorkenntnisse

Die Vorlesung baut auf dem im Bachelor „Optronik“ vermittelten Kenntnissen sowie dem Fach „Mikro- und nanotechnologien für die Optoelektronik“ sowie dem Wahlfach „Optische Emittter für die Sensor- und Informationstechnik“ auf.

Inhalt

1. Theoretische Grundlagen von Festkörperlasern 2. Grundelemente und Aufbau von Festkörperlaser und Verstärkern 3. Rauschen in Lasern 4. Optische Bistabilitäten und Festkörperlaser 5. Optisch gepumpte Festkörperlaser 6. Elektronisch gepumpte Festkörperlaser 6.1. Heterostrukturlaser 6.2. MIR und IR Laser 6.3. Intersubbandlaser 6.4. Quatenpunktlaser 6.5. Laser aus Photonischenkristallen 6.6. Si basierte Laser 7. Optische Verstärker und Frequenzwandler 8. Laserintegration 9. Degradation in Festkörperlasern und Verstärkern

Medienformen

Overhead-Folien und Tafel

Literatur

1. H.C. Casey, Jr., M.B. Panish, Heterostructure Laser, Academic Press, New York, 1978. 2. Springer Handbook of Lasers and Optics, Springer, 2007. 3. D. Bäuerle, Laser: Grundlagen und Anwendungen in Photonik, Technik, Medizin und Kunst, Wiley-VCH, 2008. 4. F.K. Kneubühl, Laser, Wiesbadn, Vieweg-Teubner, 2008. 5. J. Eichler, H.-J. Eichler, Laser: Bauformen, Strahlführung, Anwendung, Springer, 2003.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Holographie

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch, auf Nachfrage Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Sommersemester
 Englisch

Fachnummer: 885 Prüfungsnummer: 2300110

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Sinzinger

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
 Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2332

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	0	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden verstehen und analysieren Interferogramme und Hologramme. Sie verstehen und modellieren Entstehen und den Informationsgehalt von Interferogrammen. Auf der Basis eines vertieften Verständnisses der Lichtausbreitung im Sinne der skalaren Beugungstheorie synthetisieren und analysieren sie digitale und analoge Hologramme und entwickeln Anwendungen z.B. in der Messtechnik. In Vorlesungen und Übungen wird Fach-, Methoden- und Systemkompetenz vermittelt. Die Studierenden verfügen über Sozialkompetenz, die insbesondere durch intensive Förderung von Diskussion, Gruppen- und Teamarbeit vertieft wird.

Vorkenntnisse

Gute Mathematik und Physik Grundkenntnisse

Inhalt

Grundlagen der Interferometrie und Holographie; Anwendungen z.B. in der Mess-, Display-, und Speichertechnik, holographische Lithographie, digitale und Computerholographie.

Medienformen

Daten-Projektion, Tafel Folienszusammenstellung

Literatur

P. Hariharan: Optical Holography: Principles, techniques, applications. Cambridge University Press 2002. G. Saxby: Practical Holography. Prentice Hall, 1994. Aktuelle Veröffentlichungen.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
- Master Optronik 2008
- Master Optronik 2010

Master Optronik 2008
Modul: Wahlfächer

Lichtmesstechnik und -sensorik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 318 Prüfungsnummer: 2300113

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. sc. nat. Christoph Schierz

Leistungspunkte: 4 Workload (h): 120 Anteil Selbststudium (h): 86 SWS: 3.0
Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2331

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	1	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Der Studierende kann Probleme der Lichtmesstechnik analysieren und bewerten. Der Studierende hat Fachwissen zur Messung von lichttechnischen Größen. In Vorlesungen und Übungen wird Fach- Methoden- und Systemkompetenz vermittelt.

Vorkenntnisse

Lichttechnik 1 und 2

Inhalt

Lichtmessverfahren, Sensoren, Metrik

Medienformen

Arbeitsblätter

Literatur

Mc Cluny: Introduction to Radio-and Photometry

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Maschinenbau 2009
- Master Maschinenbau 2011
- Master Maschinenbau 2014
- Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
- Master Optronik 2008
- Master Optronik 2010

Master Optronik 2008
Modul: Wahlfächer

Mikrooptik 2

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
Sprache: Deutsch, auf Nachfrage Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Sommersemester
Englisch

Fachnummer: 886 Prüfungsnummer: 2300115

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Sinzinger

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2332

SWS nach Fachsemester	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	1	1	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Simulation elektromagnetischer Wellen;(25%) Design, Simulation und Anwendung integrierter und mikro- und nanooptischer Bauelemente + Systeme;(40%) mikrooptisches Systemdesign;(25) Teamarbeit, Diskussion.(10%)

Vorkenntnisse

Gute Mathematik und Physik Grundkenntnisse

Inhalt

Anwendungen mikrooptischer Bauelemente und Systeme; Neue Trends und Entwicklungen Photonische Kristalle Theorie, Simulation und Anwendungen

Medienformen

Daten-Projektion, Tafel Folienzusammenstellung

Literatur

A. Ghatak, K. Thyagarajan: Introduction to fiber optics. Cambridge University Press, 1998. B. Saleh, M. Teich: Fundamentals of Photonics. Wiley Interscience, 1991. Sinzinger/Jahns: Microoptics. Wiley-VCH, 2003

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Mikrotechnologie

Fachabschluss: Prüfungsleistung schriftlich 90 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Pflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 1607 Prüfungsnummer: 2300031

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Martin Hoffmann

Leistungspunkte: 3	Workload (h): 90	Anteil Selbststudium (h): 56	SWS: 2.0
Fakultät für Maschinenbau			Fachgebiet: 2342

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	0	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage die Mikrosystemtechnik in die Technologien der Mechatronik und des Maschinenbaus einzuordnen. Sie analysieren und bewerten Fertigungsprozesse und sind in der Lage, einfache Prozessabläufe selbst aufzustellen.

Sie können selbständig die Systemskalierung eines technischen Systems ermitteln. Sie können gegebene Anwendungsbeispiele einordnen und neue Applikationen daraus gezielt synthetisieren.

Vorkenntnisse

Gute Kenntnisse der Physik

Inhalt

Das Prinzip der Skalierung

Skalierung physikalischer Gesetze

- Anwendung des Skalierungsfaktors

Skalierung von Materialeigenschaften

- Mikro- und Nanokristallinität
- Rand- und Oberflächeneffekte

Systemeinflüsse

- systemische Betrachtungen an ausgewählten Beispielen

Materialien der Dünnschichttechnik und ihre Eigenschaften

- Silicium als mechanisches Material
- Leitende, isolierende und halbleitende Dünnschichten

Grundlagen der Dünnschichttechnik

- Reinraumtechnik
- Vakuum & Freie Weglänge
- nicht-thermisches Plasma

Umwandelnde Verfahren

- thermische Oxidation

Beschichtende Verfahren

- Physikalische Gasphasenabscheidung
- Chemische Gasphasenabscheidung

Fotolithografie

Ätzverfahren

- Trockenätzverfahren

- Ionenstrahl-Verfahren

Medienformen

Präsentation & Tafel

Foliensatz der Präsentation (kein vollständiges Skript!)

Literatur

G. Gerlach, W. Dötzel: Einführung in die Mikrosystemtechnik - Ein Kursbuch für Studierende, Hanser-Verlag 2006 (auch in Englisch verfügbar als "Introduction to Microsystem Technology", Wiley 2008)

M. Elwenspoek, H.V. Jansen "Silicon Micromachining", Cambridge Univ. Press 1998;

W.Menz, P.Bley "Mikrosystemtechnik für Ingenieure", VCH-Verlag Weinheim 1993

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Bachelor Informatik 2010

Bachelor Maschinenbau 2008

Bachelor Maschinenbau 2013

Bachelor Mechatronik 2008

Bachelor Technische Physik 2011

LA BA Berufl. Schulen LA Berufliche Schulen - Erstfach Elektrotechnik 2008 Vertiefung MR

LA BA Berufl. Schulen LA Berufliche Schulen - Erstfach Metalltechnik 2008 Vertiefung MR

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Master Wirtschaftsingenieurwesen 2009

Master Wirtschaftsingenieurwesen 2009 Vertiefung MB

Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010

Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010 Vertiefung MB

Master Wirtschaftsingenieurwesen 2011 Vertiefung MB

Mikro- und Nanoanalytik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 5626 Prüfungsnummer: 2100147

Fachverantwortlich: Dr.-Ing. Gernot Ecke

Leistungspunkte: 4 Workload (h): 120 Anteil Selbststudium (h): 86 SWS: 2.0
 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Fachgebiet: 2142

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				2	0	0															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage, aus der Kenntnis der wichtigsten Parameter und Einsatzgebiete, der Vor- und Nachteile und der physikalischen Prinzipien der Mikro- und Nanobereichs-Analyseverfahren für die Lösung einer analytischen Aufgabe geeignete Verfahren auszuwählen. Die Studierenden sind fähig, oberflächenanalytische Aufgabenstellungen zu verstehen und auf die entsprechenden Analyseverfahren anzuwenden. Die Studierenden bewerten die Ergebnisse von Mikro- und Nanobereichs-Analysen kritisch und sind in der Lage, diese zu interpretieren.

Vorkenntnisse

Grundlagenkenntnisse in Physik, Elektrotechnik, Vakuumtechnik und Werkstoffkunde

Inhalt

Die Analyse von immer kleiner werden Mikro- und Nanostrukturen umfasst die atomar-chemische, strukturelle, morphologische, elektrische und optische Charakterisierung. Dazu wird die Probe meist mit energiereicher Strahlung angeregt oder mechanisch abgetastet. Viele der analytischen Verfahren gelangen bei der Anwendung in der Mikro- und Nanotechnologie an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Erst die Kombination mehrerer Analysemethoden bringt oft erst die gewünschte Aussagekraft. Die Kenntnis der Vor- und Nachteile der Analysemethoden, der dazu notwendigen Grundlagen, ihrer Leistungsparameter und Eigenschaften ist Voraussetzung für das Verstehen von Analyseergebnissen und für den optimalen Einsatz der Analytik und Diagnostik in der Technologie. Die Lehrveranstaltung liefert einen Überblick über die wichtigsten analytischen Methoden, die in der Mikro- und Nanotechnologie Anwendung finden. Sie stellt deren physikalische Prinzipien, ihre analytischen Möglichkeiten und Grenzen dar. Dabei wird großen Wert auf Praxisrelevanz gelegt. Die Lehrveranstaltung gliedert sich in folgende Schwerpunkte: 1. Einführung in die Mikro- und Nanoanalytik 2. Wechselwirkungen von Elektronenstrahlen mit Festkörpern 3. Analytische Verfahren, die mit Elektronensonde arbeiten 4. Wechselwirkung von Photonen mit Festkörpern 5. Analytische Verfahren, die mit Photonen sonde arbeiten 6. Wechselwirkungen von Ionenstrahlen mit Festkörpern 7. Analytische Verfahren, die mit Ionen sonde arbeiten 8. Rastersonden-Verfahren

Medienformen

Tafel Folien (Overhead) Die in der Vorlesung gezeigten Folien (Abbildungen) stehen im Netz.

Literatur

wird nicht angegeben (erst in der Lehrveranstaltung)

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 Vertiefung MNE

Master Mikro- und Nanotechnologien 2008

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Optische Emittter für die Sensor- und Informationstechnik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min

Art der Notengebung: Gestufte Noten

Sprache: Deutsch, auf Nachfrage
Englisch

Pflichtkennz.:Wahlpflichtfach

Turnus:Sommersemester

Fachnummer: 7530

Prüfungsnummer:2100146

Fachverantwortlich:Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Ivo Rangelow

Leistungspunkte: 3

Workload (h): 90

Anteil Selbststudium (h): 68

SWS: 2.0

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Fachgebiet: 2143

SWS nach Fachsemester	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	0	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Optische Technologien gelten als eine der entscheidenden Schlüsseltechnologien der Zukunft. Der/die Student/in soll einen Überblick über verschiedene optische Emittter für die Sensor- und Informationstechnik und deren Grundlagen erhalten. Anhand dieser Grundlagen soll der/die Student/in für die Problematik bei der Fertigung von optischen Emitttern sensibilisiert werden. Die optische Informations- /Kommunikationstechnik bildet auch die treibende Kraft in der Entwicklung der Elektronik und der IC-Technik zu immer höheren Verarbeitungsgeschwindigkeiten. Neben der eigentlichen Informationsübertragungstechnik spielen die optischen Emittter eine zentrale Rolle in der optischen Speichertechnik, der Mikrosystemtechnik der Sensorik, der Display-Technik, als Pumpquellen für kompakte Festkörper-Laser, Komponenten für die höchstbitratige optische Kommunikationstechnik, optische Nachrichtentechnik, optische Datenspeicherung etc.

Vorkenntnisse

Grundkenntnisse der Festkörper-, Halbleiter- und Atomphysik

Inhalt

Grundlagen der optischen Emittter; Einführung in die gängigsten optischen Emittter für die Sensor- und Informationstechnik; Einblick in den aktuellen Stand der Forschung und industrielle Anwendungen für die kostengünstige Herstellung von optischen Emitttern und der optischen Informationsübertragung. Schwerpunkte der Lehre "Optische Emittter für die Sensor- und Informationstechnik": - Laserphysik, Lasertechnik; Halbleiterphysikalische Grundlagen; - Komponenten für die höchstbitratige optische Kommunikationstechnik; - Sensorik und Aktuatorik , Mikro- und Nanooptische Systeme; Herstellung von Nanostrukturen für die Manipulation von Licht auf der Nanometerskala; - Charakterisierung von optoelektronischen Bauelementen; - Mikro- und Nanostrukturen für die Systemtechnik; Verkleinerte optische Systeme mit hoher Funktionalität (Lichtquellen, Wellenleiter, Strahlteiler, Intensitäts- oder Phasen-Modulatoren, Filter, Schalter usw.) als System; - Optische Nachrichtentechnik; Abbildende optische Systeme; Vollintegrierte optoelektronische Anwendungen auf Si-Basis; - Lasermaterialbearbeitung; - Lasermedizin; Biomedizinische optische Systeme.

Medienformen

Powerpoint Präsentationen, Videos, Tafel

Literatur

J. Gowar: Optical Communication Systems, 2nd Ed., Prentice Hall, 1993 Bludau, W.: Lichtwellenleiter in Sensorik und optischer Nachrichtentechnik, 1.Aufl., Springer, 1998 K. J. Ebeling: Integrierte Optoelektronik, 2. Aufl., Springer Verlag, 1992H. Hultsch: Optische Telekommunikationssysteme, Damm Verlag, 1996 L. A. Coldren and S. W. Corzine: Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits, John Wiley, New York 1995 P. Bhattacharya: Semiconductor Optoelectronic Devices, 2nd

edition, Prentice Hall, London 1997

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Optische Koordinatenmesstechnik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 403 Prüfungsnummer: 2300117

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Gerhard Linß

Leistungspunkte: 4 Workload (h): 120 Anteil Selbststudium (h): 86 SWS: 3.0
 Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2362

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	1	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden überblicken das Gebiet der Koordinatenmesstechnik hinsichtlich Aufbau, Funktion und messtechnischer Eigenschaften der Antastsensoren und der Gesamtgeräte. Die Studierenden sind fähig, Aufgaben der Koordinatenmessung zu analysieren, geeignete Geräte und Messabläufe auszuwählen und entsprechende Messergebnisse zu gewinnen. Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen und der seminaristischen bzw. praktischen Arbeit an der Koordinatenmessmaschine.

Vorkenntnisse

Bachelorabschluss einer naturwissenschaftlichen oder technischen Fachrichtung mit messtechnischen Grundfächern z.B. Mess- und Sensortechnik; Fertigungs- und Lasermesstechnik 1 und 2 werden empfohlen.

Inhalt

Aufbau und Funktion von Koordinatenmessgeräten, Fehlereinflüsse, Tastereinflüsse, Messsoftware CALYPSO, Koordinatentransformation, Messwertgewinnung, CNC-Ablauf, Scannen; Messen mit einer 3D-Koordinatenmessmaschine.

Medienformen

Tafel und Kreide, Beamer/Laptop/Präsentationssoftware

Literatur

- Ein aktuelles Literaturverzeichnis ist Bestandteil des Lehrmaterials
- Weckenmann, Albert (Hrsg.): Koordinatenmesstechnik: flexible Strategien für funktions- und fertigungsgerechtes Prüfen. 2., vollst. überarb. Aufl., München, Hanser 2012, ISBN 978-3-446-40739-8

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Maschinenbau 2009
- Master Maschinenbau 2011
- Master Maschinenbau 2014

Master Mechatronik 2008

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Master Optronik 2008
 Modul: Wahlfächer

Optische Messtechnik/ Optik-Praktikum

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 882 Prüfungsnummer: 2300118

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Sinzinger

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
 Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2332

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	1	0	1																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden haben praktische Erfahrungen im Umgang mit optischen und optoelektronischen Bauelementen und Systemkomponenten. Sie sind in der Lage diese Systemkomponenten entsprechend experimentell zu charakterisieren, in komplexen Versuchsaufbauten einzusetzen und die Versuchsergebnisse auszuwerten und zu bewerten. Sie sind mit dem Umgang und der Verarbeitung von elektronischen und optischen Signalen vertraut. Die Studierenden verfügen über Sozialkompetenz, die insbesondere durch intensive Förderung von Diskussion und Teamarbeit an den Praktikumsversuchen vertieft wird.

Vorkenntnisse

Gute Mathematik- und Physikgrundkenntnisse

Inhalt

Messung an optischen Abbildungssystemen, MTF- Messung, optische Geometrie und Längenmessung, Streulichtmesstechnik

Medienformen

Daten-Projektion, Folien, Tafeln, Vorlesungsskript

Literatur

W. Richter: Optische Messtechnik. Vorlesungsskript TU Ilmenau. H. Haferkorn: Optik. 4. Auflage, Wiley-VCH 2002. E. Hecht: Optik. Oldenbourg, 2001.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Maschinenbau 2009
- Master Maschinenbau 2011
- Master Maschinenbau 2014
- Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
- Master Optronik 2008

Optoelektronische Mess- und Sensortechnik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 5559 Prüfungsnummer: 2300119

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Eberhard Manske

Leistungspunkte: 5 Workload (h): 150 Anteil Selbststudium (h): 105 SWS: 4.0
 Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2373

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	3	1	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden überblicken das Gebiet der Optoelektronischen Mess- und Sensortechnik von den metrologischen Grundlagen über Eigenschaften und Anwendungsbereiche der Messverfahren und -prinzipien bis zum Kostenfaktor. Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen optoelektronische Komponenten erkennen und bewerten. Die Studierenden sind fähig, zur Lösung einer Messaufgabe geeignete optoelektronische Messverfahren, -geräte oder Komponenten auszuwählen und entsprechende Messunsicherheitsbudgets vorzulegen. Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen und der gemeinsamen Problemlösung im Seminar.

Vorkenntnisse

Messtechnische Kenntnisse aus den Lehrveranstaltungen "Mess- und Sensortechnik" (B.Sc. MB/MTR/OTR/FZT) bzw. "Prozessmess- und Sensortechnik 1 und 2" (B.Sc.-EIT). "Fertigungs- und Lasermesstechnik 1 und 2".

Inhalt

Grundlagen der Optoelektronik für die Anwendung in der Messtechnik, Laserlichtquellen und Lichtwellenleiter, Faseroptische Sensoren, Optoelektronische Messverfahren für Geschwindigkeit, Oberfläche, Form, Ebenheit u.a.

Medienformen

Tafel und Kreide, aber auch Nutzung der Möglichkeiten von Laptop mit Präsentationssoftware oder Overheadprojektor mit Folien je nach Raumausstattung.

Literatur

Eine permanent aktualisierte Übersicht der entsprechenden Spezialliteratur wird gegeben.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 Vertiefung AST
- Master Maschinenbau 2009
- Master Maschinenbau 2011

Master Maschinenbau 2014

Master Mechatronik 2008

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Master Optronik 2008
Modul: Wahlfächer

Physiologische Optik und Psychophysik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 7485 Prüfungsnummer: 2300120

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. sc. nat. Christoph Schierz

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2331

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	1	1	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden kennen die Grundlagen der visuellen Funktionen und wissen, wie diese mit dem Alltag und mit technischen Anwendungen in Bezug zu setzen sind. Der Teil Psychophysik befähigt zur Untersuchung der Wahrnehmungsfunktionen von Testpersonen.

Vorkenntnisse

keine, Grundkenntnisse in Lichttechnik (z.B. Vorlesung Lichttechnik 1) von Vorteil

Inhalt

Physiologische Optik: Aufbau und Funktion des Auges, Sehraum, Raum- und Tiefensehen, Helligkeit, Kontrast, Farbe, zeitliche Faktoren, circadiane Lichtwirkungen, Umweltwahrnehmung. Psychophysik: Klassische Psychophysik, Methoden der klassischen Psychophysik, Signaldetektion, Skalierungsmethoden

Medienformen

Entwicklung an Tafel, Powerpoint-Folien (werden zur Verfügung gestellt), teilweise Skript, Übungs- und Informationsblätter

Literatur

Literatur ist fakultativ. - Goldstein E.B.: Wahrnehmungspsychologie. 7. Aufl., Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg (2007) - Gregory R.L.: Auge und Gehirn. Psychologie des Sehens. Rowohlt Tb. (2001). - Schmidt R. F., Schaible H.-G.: Neuro- und Sinnesphysiologie. 5. Aufl. Springer, Berlin (2006). - Gescheider G. A.: Psychophysics: Method, Theory, and Application. 3rd Ed., Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey (1997).

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Biomedizinische Technik 2009
- Master Maschinenbau 2009
- Master Maschinenbau 2011
- Master Maschinenbau 2014
- Master Medientechnologie 2009

Master Medientechnologie 2013

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Master Optronik 2008
 Modul: Wahlfächer

Silizium-Photovoltaik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Pflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 7362 Prüfungsnummer: 2400294

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Gobsch

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
 Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften Fachgebiet: 2422

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				1	1	0															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Lehrveranstaltung vermittelt Grundlagen der photovoltaischen Energieumwandlung und speziell die Bauformen, Herstellungstechnologien und Meßmethoden von Silizium-Solarzellen

Vorkenntnisse

Bachelor Technische Physik oder äquivalenter Bachelorabschluss

Inhalt

Grundlagen der Photovoltaischen Energieumwandlung, Halbleiterphysikalische Grundlagen, Aufbau und Typen von kristallinen und Dünnschicht solarzellen, Herstellungstechnologien, Meßverfahren

Medienformen

Vorlesungen mit Tafel, Folien, Beamer Übungsaufgaben

Literatur

P. Würfel, Physik der Solarzellen Wagemann/Eschrich, Grundlagen der photovoltaischen Energieumwandlung F. Falk, Script zur Vorlesung "Physik und Technologie von Solarzellen", IPHT Jena, D. Meissner, Solarzellen

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
- Master Optronik 2008
- Master Optronik 2010
- Master Regenerative Energietechnik 2011
- Master Regenerative Energietechnik 2013
- Master Technische Physik 2008
- Master Technische Physik 2011

SMD- und Hybridtechnik (AVT-Workshop)

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: ganzjährig

Fachnummer: 67 Prüfungsnummer: 2100149

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jens Müller

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Fachgebiet: 2146

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	0	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage die Prozesse der Dickschichttechnik anzuwenden. Sie kennen die Unterschiede zu anderen Trägertechnologien.

Fachkompetenzen: Werkstoffwissenschaftliche und ingenieurtechnische Grundlagen, Verhalten in Reinräumen.

Methodenkompetenz: Systematisches Erfassen von Problemstellungen, Anwendung des Fachwissens, Anwendung von Prozessen zur Herstellung eines Hybridschaltkreises, Dokumentation von Ergebnissen.

Systemkompetenzen: Verstehen der Einflüsse der technologischen Schaltungsumsetzung auf deren Funktion, Entwicklung interdisziplinären Denkens (Wechselwirkung Design, Material, Technologie).

Sozialkompetenzen: Kommunikation, Teamfähigkeit, Beachtung arbeitsschutzrechtlicher Aspekte für die Schaltungsrealisierung.

Vorkenntnisse

Grundlagen Elektrotechnik und Elektronik

Inhalt

Materialien, Prozessablauf und Geräte für die Dickschichttechnik (DS) als Integrationstechnik, Herstellung eines kompletten DS-Schaltkreises einschließlich der gedruckten passiven Bauelemente und SMD-Bestückung sowie der abschließenden Prüfung

Medienformen

Praktikum mit Anleitung

Literatur

Skript Hybridtechnik, Handbuch der Leiterplattentechnik Band 4, Eugen Leuze Verlag ISBN3-87480-184-5

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Synthese optischer Systeme/ Optiksoftware

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 883 Prüfungsnummer: 2300121

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Sinzinger

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
 Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2332

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	1	1	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden analysieren, verstehen und optimieren optische Abbildungssysteme zunehmender Komplexität. Sie wenden vertiefte Kenntnisse der wellenoptischen Beschreibung optischer Bauelemente und Systeme an für die Synthese spezieller optischer Systeme an. Sie modellieren und optimieren optische Abbildungssysteme auf der Basis der diskutierten Modellbeschreibungen und einschlägiger Optik-Design Programme. In Vorlesungen und Übungen wird Fach-, Methoden- und Systemkompetenz vermittelt. Die Studierenden verfügen über Sozialkompetenz, die insbesondere durch intensive Förderung von Diskussion, Gruppen- und Teamarbeit vertieft wird.

Vorkenntnisse

Gute Mathematik und Physik Grundkenntnisse; Gute Optik Grundkenntnisse

Inhalt

Paraxialer Entwurf optischer Systeme, analytischer Synthese optischer Systeme, Optimierung und Korrektur optischer Systeme

Medienformen

Daten-Projektion, Folien, Tafel Vorlesungsskript

Literatur

W. Richter: Synthese optischer Systeme, Vorlesungsskript TU Ilmenau. H. Haferkorn: Optik, 4. Auflage, Wiley-VCH 2002. E. Hecht: Optik, Oldenbourg, 2001.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Maschinenbau 2009
- Master Maschinenbau 2011
- Master Maschinenbau 2014
- Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
- Master Optronik 2008

Master Optronik 2008
Modul: Wahlfächer

Beleuchtungstechnik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 316 Prüfungsnummer: 2300106

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. sc. nat. Christoph Schierz

Leistungspunkte: 4 Workload (h): 120 Anteil Selbststudium (h): 86 SWS: 3.0
Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2331

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				2	1	0															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage, Beleuchtungsaufgaben zu analysieren, umzusetzen und zu bewerten. Sie lernen die Gütemerkmale der Beleuchtung kennen und anzuwenden.

Vorkenntnisse

keine
Lichttechnik 1 von Vorteil

Inhalt

Gütemerkmale der Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Tageslicht, Lichtberechnungen, Lichtplanung, weitere Lichanwendungen

Medienformen

Arbeitsblätter

Literatur

Baer: Beleuchtungstechnik

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Maschinenbau 2009
- Master Maschinenbau 2011
- Master Maschinenbau 2014
- Master Medientechnologie 2009
- Master Medientechnologie 2013
- Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
- Master Optronik 2008

Digitale Signalverarbeitung

Fachabschluss: Prüfungsleistung schriftlich 90 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Pflichtfach Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 1356 Prüfungsnummer: 2100019

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gerald Schuller

Leistungspunkte: 4 Workload (h): 120 Anteil Selbststudium (h): 86 SWS: 3.0
 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Fachgebiet: 2114

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	2	1	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden kennen grundlegende Zusammenhänge der diskreten Signalverarbeitung. Sie bewerten Verfahren der Analog-Digital-Wandlung in Bezug auf ihre Anwendungseigenschaften. Die Studierenden wenden grundlegende Signalverarbeitungsalgorithmen (diskrete Transformationen, Korrelation, Faltung, sowie zeitdiskrete Filter, Fehlerkorrektur, Chiffrierung und numerische Algorithmen) und analysieren ihren Einsatz in komplexen Signalverarbeitungsaufgaben. Sie analysieren und synthetisieren zeitdiskrete Filter und diskrete Transformationen in modernen Anwendungen der Sprach- und Bildverarbeitung sowie Messtechnik. Die Studierenden wenden grundsätzliche Zusammenhänge der Fehlerkorrekturverfahren und Chiffrierung an. Die Studierenden sind in der Lage, Verfahren der Digitalen Signalverarbeitung anzuwenden, zu bewerten und differenzierte Soft- und Hardware-Realisierungen zu synthetisieren.

Vorkenntnisse

Pflichtfächer in den Semestern 1-4, Nachrichtentechnik Sem. 5 (Vorlauf)

Inhalt

- Analog-Digital-Umsetzer und Digital-Analog-Umsetzer; - Rhythmische und arhythmische Interpolationsverfahren: Tiefpaß-, Lagrange- und Spline-Interpolation. - Ein- und mehrdimensionale diskrete Transformationen: Diskrete Fouriertransformation, Fast-Fourier-Transformation, Hartley-Transformation, Diskrete Cosinus-Transformation, Walsh/Hadamard-Transformation, Haar-Wavelets, Karhunen-Loeve-Transformation; Gram-Schmidt-Verfahren, Laplace- und Z-Transformation. - Zeitdiskrete Systeme, Digitale Filter - Strukturen und Beschreibung im Zeit- und Frequenz-bereich - Katalog-Filterrealisierungen, Lattice-Filter - Beschreibung Digitaler Filter durch Zustandsgrößen. - Numerisches Glätten, Differenzieren und Integrieren. - Diskrete Faltung, diskrete Autokorrelationsfunktion und diskrete Kreuzkorrelationsfunktion - Zufallsgeneratoren, Fehlerkorrektur, Chiffrierung - Einsatz von Signalprozessoren in der Digitalen Signalverarbeitung

Medienformen

Folienpräsentation Elektronische Präsentationen Übungsscript Tafelanschrieb Folienskript bei Copy-Shop erhältlich
 Literaturverweise und Liste mit Prüfungsfragen online

Literatur

Kreß, D. ; Imer, R. : Angewandte Systemtheorie, Verlag Technik 1990 Harmuth, H.F.: Transmission of information by Orthogonal Functions, Springer Verlag 2. Aufl. 1972 Schrüfer, E.: Signalverarbeitung, Carl Hanser Verlag 1992 Johnson, J. R.: Digitale Signalverarbeitung, Carl Hanser Verlag 1991 Krüger, K.-E.: Transformationen, Vieweg 2002 Kroschel, K.: Statistische Nachrichtentheorie, 3. Auflage Springer-Verlag 1999, ISBN 3-540-61306-4 Fliege, N.: Multiraten-Signalverarbeitung, B.G.Teubner Stuttgart 1993, ISBN 3-519-06140-6 Pratt, W.K.: Digital Image Processing, Wiley & Sons Inc. 2001, ISBN 0-471-37407-5 Mertins, A.: Signaltheorie, Teubner-Verlag 1996, ISBN 3-519-06178-3

verwendet in folgenden Studiengängen

Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2008
Bachelor Informatik 2010
Bachelor Ingenieurinformatik 2008
Bachelor Medientechnologie 2008
Bachelor Medientechnologie 2013
Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
Master Optronik 2008
Master Optronik 2010
Master Wirtschaftsingenieurwesen 2009
Master Wirtschaftsingenieurwesen 2009 Vertiefung ET
Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010
Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010 Vertiefung ET
Master Wirtschaftsingenieurwesen 2011 Vertiefung ET

Master Optronik 2008
Modul: Wahlfächer

Farbe und Farbmatrik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 317 Prüfungsnummer: 2300107

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. sc. nat. Christoph Schierz

Leistungspunkte: 4 Workload (h): 120 Anteil Selbststudium (h): 86 SWS: 3.0
Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2331

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				2	0	1															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden können: Die Zusammenhänge zwischen der Farbwahrnehmung und den verschiedenen Farbbeschreibungen verstehen und berechnen, die dazugehörigen Messgeräte einsetzen und mit Farbbeimpfindungsmodellen und abgeleiteten Größen (z.B. Farbwiedergabeindex, Farbdifferenz) umgehen.

Vorkenntnisse

Lichttechnik 1 von Vorteil

Inhalt

Niedere Farbmatrik, Höhere Farbmatrik, Farbwiedergabe, Farbwirkungen

Medienformen

Arbeitsblätter

Literatur

Lang: Farbe in den Medien; Lee: Introduction to Color Imaging Science

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Maschinenbau 2009
- Master Maschinenbau 2011
- Master Maschinenbau 2014
- Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
- Master Optronik 2008
- Master Optronik 2010

Lasertechnik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch, auf Nachfrage Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Wintersemester
 Englisch

Fachnummer: 881 Prüfungsnummer: 2300112

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Sinzinger

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
 Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2332

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				2	0	0															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden analysieren optische Laserlichtquellen. Sie verstehen das Konzept der Vielstrahlinterferometrie in optischen Resonatoren. Sie modellieren, analysieren und bewerten optische Wellen auf der Basis der Gaußschen Strahlwellen und verstehen Auswahlkriterien für Laserquellen. In Vorlesungen und Übungen wird Fach-, Methoden- und Systemkompetenz vermittelt. Die Studierenden verfügen über Sozialkompetenz, die insbesondere durch intensive Förderung von Diskussion, Gruppen- und Teamarbeit vertieft wird.

Vorkenntnisse

Gute Mathematik und Physik Grundkenntnisse

Inhalt

Laserstrahlung, -aufbau, Resonatoroptik, Gaußsche Strahlen; Eigenschaften, Anwendungen, Typen von Lasern

Medienformen

Daten-Projektion, Folien, Tafeln Folienzusammenstellung

Literatur

A. Siegmann: Laser. Univ. Science Books, 1986. B. Saleh, M. Teich: Fundamentals of Photonics. Wiley Interscience, 1991. J. Eichler, H.-J. Eichler: Laser: Bauformen, Strahlführung, Anwendungen. Springer 2002.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Maschinenbau 2009
- Master Maschinenbau 2011
- Master Maschinenbau 2014
- Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
- Master Optronik 2008
- Master Optronik 2010

Messdatenauswertung und Messunsicherheit

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 7451 Prüfungsnummer: 2300158

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Fröhlich

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
 Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2372

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				2	0	0															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden sind mit der Messdatenauswertung und Messunsicherheit vertraut. Die Studierenden überblicken, eingebettet in die systemische Betrachtungsweise der Mess- und Automatisierungstechnik die Verfahrensweise der Ermittlung der Messunsicherheit und des vollständigen Messergebnisses. Die Studierenden können bestehende Messanordnungen hinsichtlich der Messunsicherheit analysieren. Die Studierenden sind fähig Messunsicherheitsbudgets aufzustellen und das vollständige Messergebnis anzugeben. Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen und der gemeinsamen Problemlösung im Seminar.

Vorkenntnisse

Bachelor Technik (GIG)

Inhalt

1. Messsysteme und Strategien zur Messdatenauswertung, Begriffe, Definitionen, Funktionsstrukturen, Kennlinien, Beobachtungen, Einflüsse und Parameter, grundlegende Modellvorstellungen zur Messdatenauswertung
 2. Statistische Analyse von beobachteten Werten, Zufall, Häufigkeit, Wahrscheinlichkeit, bedingte Wahrscheinlichkeit, Bayes'sche Formel, Verteilung, Grundgesamtheit und Stichprobe, Auswerten von Stichproben, Grenzen der statistischen Messdatenauswertung
 3. Bewertung unvollständiger Kenntnisse über Größen und Messsysteme, Bayes'scher Wahrscheinlichkeitsbegriff, Bewerten nicht-statistischer Kenntnisse und systematischer Effekte in der Messdatenauswertung
 4. Messunsicherheitsbewertung nach dem ISO-GUM-Verfahren, ISO-GUM-Verfahren a. H. von Beispielen, Systematische Modellbildung
 5. Rechnergestützte Messunsicherheitsbewertung nach GUM, rechnergestützte Messunsicherheitsbewertung a. H. von Beispielen, Berechnen der Messunsicherheit aus Ringversuchsergebnissen, Grenzen des ISO-GUM-Verfahrens
 6. Korrelation und Regressionsrechnung, Gegenseitige Abhängigkeit von Größen, Statistische und logische Korrelation, Berücksichtigung von Korrelation in der Messunsicherheitsbewertung, Lineare Regressionsrechnung
 7. Bayes-Messdatenauswertung, Grundlagen, Anwendung (GUM-Supplement), Rechenregeln, weitere Entwicklungen (dynamische und verteilte Systeme)
 Alle Vorlesungseinheiten beinhalten praktische Übungen.

Medienformen

*.ppt-Präsentation, Tafel und Kreide, Unterlagen und Berechnungssoftware werden zur Verfügung gestellt.

Literatur

Aktuelles Literaturverzeichnis ist Bestandteil der Arbeitsblätter DIN V ENV 13005 (Juni 1999) Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen - Deutsche Fassung ENV 13005:1999

verwendet in folgenden Studiengängen

Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2010

Master Maschinenbau 2009

Master Maschinenbau 2011

Master Maschinenbau 2014

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Metrologie und Qualitätssicherung

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 7535 Prüfungsnummer: 2300114

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Gerhard Linß

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
 Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2362

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				2	0	0															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage, Messungen und Prüfungen sowie Strukturen zur metrologischen Rückführbarkeit von Messungen und Kalibrierungen einschließlich der metrologiespezifischen Qualitätssicherungsmaßnahmen wie Messunsicherheitsangaben und Ergebnisse von Ringvergleichsmessungen quantitativ zu bewerten. Sie haben das Fachwissen, Messgeräte zertifizieren nach der EU-Messgeräte richtlinie vorzubereiten. Die Studierenden können ein Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm ISO/IEC 17025 für ein kompetentes Mess- und Kalibrierlabor zu entwerfen.

Vorkenntnisse

Kenntnisse Physik, Grundkenntnisse Qualitätsmanagement

Inhalt

- Größen, Einheiten und Fundamentalkonstanten, künftige Neudefinition von kg, A und K, Realisierung und Weitergabe der Einheiten - Metrologische Infrastruktur (insbesondere internationale und regionale Strukturen), "global measurement system"
- Konformitätsbewertung und gesetzliches Messwesen in Deutschland und in der EU (insbes. Modulsystem der Konformitätsbewertung gemäß EU-Messgeräte richtlinie) - Kompetenz und Qualitätssicherung metrologischer Laboratorien gemäß ISO/IEC 17025 - Bewertung der Messunsicherheit, Durchführung und Auswertung von Ringvergleichen und Eignungsprüfungen, „Calibration and Measurement Capability“ (CMC)

Medienformen

Selbst geschriebene Lehrprogramme per Beamer (Projektor) und als Skripte, Arbeitsblätter, Tafel und Kreide, Anschauungsobjekte

Literatur

- Vorlesungsskript - Le Système international d'unités The International System of Units. 8e édition 2006. Bureau international des poids et mesures (BIPM). www.bipm.org - DIN EN ISO/IEC 17025

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Maschinenbau 2009
- Master Maschinenbau 2011
- Master Maschinenbau 2014

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Nano- und Lasermesstechnik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 413 Prüfungsnummer: 2300116

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Eberhard Manske

Leistungspunkte: 4 Workload (h): 120 Anteil Selbststudium (h): 86 SWS: 3.0
 Fakultät für Maschinenbau Fachgebiet: 2373

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				2	0	1															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden überblicken die Messprinzipien, Messverfahren und Messgeräte der Nanometer-Längen- und -Oberflächenmesstechnik hinsichtlich Aufbau, Funktion und Eigenschaften der Geräte und Verfahren, mathematischer Beschreibung als Grundlage der Messunsicherheitsanalyse, Anwendungsbereiche und Kosten.

Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen die eingesetzten Prinzipien erkennen und entsprechend bewerten.

Die Studierenden sind fähig, entsprechende Messaufgaben in der Nano- und Lasermesstechnik zu analysieren, geeignete, insbesondere moderne laserbasierte Messverfahren zur Lösung der Messaufgaben auszuwählen und anhand des Unsicherheitsbudgets die messtechnischen Eigenschaften zu bewerten.

Mit der Lehrveranstaltung erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden-, System- und Sozialkompetenz. Im Praktikum arbeiten die Studierenden selbständig und systematisch an den Praktikumsaufgaben und nutzen in der Vorbereitungsphase Möglichkeiten zur Konsultation bei den Praktikumsassistenten oder die studentische horizontale (matrikelinterne) oder vertikale (matrikelübergreifende) Kommunikation um ergänzende Informationen über die messtechnischen Zusammenhänge in den Versuchen zu erhalten. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen und der gemeinsamen Laborarbeit.

Vorkenntnisse

Bachelor einer technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung

Inhalt

Funktion und Einsatz von laserinterferometrischen Sensoren in der Präzisionsmesstechnik, Laserlichtquellen, He-Ne-Laser, Verstärkungskurve, Stabilisierung, Interferometerklassierung, Homodyn- und Heterodyn-Interferometer, System interferenzoptischer Sensoren, Design und messtechnische Anwendung von Miniatur-Interferometern, integriert-optische Interferometer, Polarisationsoptische Interferometer, Planspiegel-Interferometer, 3D-Messung und -Positionierung, Nanomessmaschine, Grundlagen der Oberflächenmesssysteme, Autofocus, Laserlichtschnitt, Aufbau und Funktion von STM / AFM, AFM mit 3D-Interferometermesssystem.

Medienformen

Nutzung *.ppt oder Folien je nach Raumausstattung;

Literatur

Aktuelles Literaturverzeichnis ist Bestandteil der Arbeitsblätter

tm - Technisches Messen Vol. 76, No. 5, 05/2009

International Conference on Precision Measurement (ICPM2008) Part 1: Nanomeasuring and Nanopositioning Technology

Tilo Pfeifer. Fertigungsmeßtechnik. Oldenburg. 2001

ISBN 3-486-25712-9

Nanoscale Calibration, Standards and Methods - Dimensional and Related Measurements in the Micro- and Nanometer Range; Wiley-VHC Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Edition: Wilkening, Günter; Koenders, Ludger; 2005

ISBN 3-527-40502-X

K. Hasche, W. Mirande, G. Wilkening (Eds.)2001PTB-F-39: Proceedings of the 4th Seminar on Quantitative Microscopy QM 2000 Wirtschaftsverlag NW

ISBN 3-89701-503-X

Th. Kleine-Besten 2001 PTB-F-41: Messung dreidimensionaler Mikrostrukturen Wirtschaftsverlag NW ISBN 3-89701-698-2

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2010

Master Mechatronik 2008

Master Mikro- und Nanotechnologien 2008

Master Mikro- und Nanotechnologien 2013

Master Miniaturisierte Biotechnologie 2009

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Organische Photovoltaik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch, auf Nachfrage Pflichtkennz.: Pflichtfach Turnus: Sommersemester
 Englisch

Fachnummer: 7363 Prüfungsnummer: 2400292

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Gobsch

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
 Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften Fachgebiet: 2422

SWS nach Fachsemester	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
1	1	1	0																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden besitzen einen Überblick über die grundlegenden Konzepte organischer Halbleiter und kennen die Physik der wesentlichen Bauelemente OLED und OFET. In Bezug auf den Aufbau und die Funktionsweise der organischen Solarzelle haben sie vertiefte Kenntnisse. Sie kennen die wesentlichen Materialsysteme und Produktionsparameter. Ansätze zur Skalierung auf industrielle Produktionsmaßstäbe (roll-to-roll) sind ihnen bekannt.

Vorkenntnisse

Quantenphysik, Grundkenntnisse in Halbleiterphysik und Molekülphysik (nützlich aber nicht notwendig)

Inhalt

Überblick über die Grundlagen von organischen Halbleitern: Chemischer Aufbau, elektrische und optische Eigenschaften
 Physik der Bauelemente: Organische Solarzelle, organische Leuchtdiode, organische Feldeffekttransistoren
 Ladungsträgerinjektion und Transport
 Bestimmung von Ladungsträgermobilitäten
 Überblick zu Materialsystemen in der organischen Photovoltaik und zum Stand der Technik
 Ausblick in Richtung Massenproduktion: Konzepte und Herausforderungen

Medienformen

PowerPoint-Präsentationen mit Animationen (Beamer & PDF), Fachpublikationen, Internet- und Literaturrecherchen

Literatur

- C. Brabec, V. Dyakonov, J. Parisi, N.S. Sariciftci: Organic Photovoltaics: Concepts and Realization, Springer Verlag Berlin (2003)
 S.-S. Sun, N.S. Sariciftci: Organic Photovoltaics: Mechanisms, Materials, and Devices (Optical Science and Engineering), CRC Press, Taylor & Franzis Boca Raton (2005)
 H. Hoppe and N. S. Sariciftci, Polymer Solar Cells, p. 1-86, in Photoresponsive Polymers II, Eds.: S. R. Marder and K.-S. Lee, Advances in Polymer Science, Publ.: Springer Berlin-Heidelberg (2008)
 C. Brabec, U. Scherf, V. Dyakonov: Organic Photovoltaics: Materials, Device Physics, and Manufacturing Technologies, Wiley-VCH Weinheim
 A. Moliton: Optoelectronics of Molecules and Polymers, Springer, Series in Optical Sciences (2006)

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Master Regenerative Energietechnik 2011

Master Regenerative Energietechnik 2013

Master Technische Physik 2008

Master Technische Physik 2011

Master Technische Physik 2013

Photovoltaikanlagen

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 5499 Prüfungsnummer: 2100148

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank Berger

Leistungspunkte: 3 Workload (h): 90 Anteil Selbststudium (h): 68 SWS: 2.0
 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Fachgebiet: 2162

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				2	0	0															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studenten sind befähigt, ausgehend von den physikalischen Vorgängen und Prozessen der solarelektrischen Energiewandlung, technische Parameter abzuleiten. Sie sind in der Lage, ingenieurtechnische relevante Herstellungstechniken von Solarzellen und Modulen zu analysieren und entsprechende Technologien anzuwenden. Die Studenten sind fähig, selbstständig Photovoltaikanlagen (Hausanlagen und Kraftwerke) zu entwerfen, zu dimensionieren und zu projektieren. Sie können die standortspezifischen Einflussgrößen auf das solare Angebot und den Elektroenergieertrag analysieren, bestimmen und für das Vorhaben spezifisch nutzen. Sie sind mit den aktuell auf dem Markt angebotenen Photovoltaik-Komponenten vertraut und in der Lage, ihre Anwendung für das Vorhaben zu bewerten. Sie sind befähigt, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung auch bei sich ändernden Rahmenbedingungen selbstständig durchzuführen.

Vorkenntnisse

Grundlagen der Elektrotechnik, Grundlagen der Elektrischen Energietechnik

Inhalt

Teil 1: Energieverbrauch und Umweltschutz, Solarstrahlung, Physik der Solarzelle, Solarzellentypen (Funktion, Aufbau, Herstellung), Kennlinien und Kennwerte von Zellen und Modulen Teil 2: Autonome Hausanlage; ihre Bestandteile (Laderegler, Akku, DC/DC-Wandler), Energiebedarfsbestimmung und Anlagenbemessung; Netzgekoppelte Hausanlage; ihre Bemessung, Solargeneratorgestaltung und Anlagenbemessung; Photovoltaik-Kraftwerk; Anlagenkonzepte, Schaltungskonzepte des Wechselrichters, Komponentenbemessung und Projektierungsgrundsätze; Ausführungsbeispiele; Ertragsabschätzung

Medienformen

Skript, Versuchsanleitungen, Video, Exponate, Exkursion, Demonstrationsanlage

Literatur

Götzberger, A.: Sonnenenergie: Photovoltaik, Teubner 1997 Weik, H.: Wärme und Strom aus Sonnenenergie, Müller C.F. 1994 VDEW-Richtlinien, Netzkopplung mit NS-, MS- und HS-Netz, 2002 Kaltschmitt, M.; Streicher, W.: Erneuerbare Energien, Springer, Berlin 2004

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Master Optronik 2008
Modul: Wahlfächer

Praktikum Lichttechnik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich

Art der Notegebung: Generierte Noten

Sprache: Deutsch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: Wintersemester

Fachnummer: 325

Prüfungsnummer: 2300208

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. sc. nat. Christoph Schierz

Leistungspunkte: 3

Workload (h): 90

Anteil Selbststudium (h): 56

SWS: 3.0

Fakultät für Maschinenbau

Fachgebiet: 2331

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				0	0	3															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Der Student kann die Lichtmesstechnik anwenden. Er ist in der Lage, Messgeräte auszuwählen, anzuwenden und Messfehler abzuschätzen.

Vorkenntnisse

Lichttechnik 1 und 2

Inhalt

Lichttechnik, Farbtechnik, Messungen, Bewertungen

Medienformen

Praktikumsanleitungen

Literatur

Gall: Grundlagen der Lichttechnik Baer: Beleuchtungstechnik

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Praktikum Photovoltaik

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notegebung: Generierte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Pflichtfach Turnus: Sommersemester

Fachnummer: 7364 Prüfungsnummer: 2400293

Fachverantwortlich: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Gobsch

Leistungspunkte: 1 Workload (h): 30 Anteil Selbststudium (h): 19 SWS: 1.0
 Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften Fachgebiet: 2422

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
	0	0	1																		

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studenten erlernen die praktische Präparation von einigen optoelektronischen Bauelementen, wie z.B. organische Leuchtdioden (OLED), organische Solarzellen (OSC) und organische Feldeffekttransistoren (OFET).

Vorkenntnisse

Grundkenntnisse der Festkörper-, Halbleiter- und Atomphysik, kann parallel oder in der Folge zur Vorlesung "Organische Optoelektronik" besucht werden.

Inhalt

Praktische Präparation im Labor (Reinraum, Substratpräparation, Schleuderbeschichtung, Vakuumsublimation von Metallen, Charakterisierung der Bauelemente).

Medienformen

Versuchsanleitungen werden bereitgestellt.

Literatur

M.D. McGehee, E.K. Miller, D. Moses, and A.J. Heeger, in *Advances in Synthetic Metals, Twenty Years of Progress in Science and Technology*, edited by P. Bernier, S. Lefrant, and G. Bidan (Elsevier, Lausanne, 1999), p. 98
Handbook of Conducting Polymers; Vol. 1-2, edited by T.A. Skotheim and J.R. Reynolds (CRC Press, Boca Raton, 2006)
 H. Hoppe and N.S. Sariciftci, Organic solar cells: an overview, *J. Mater. Res.* 19, 1924 (2004)

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

- Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014
- Master Optronik 2008
- Master Optronik 2010
- Master Technische Physik 2008
- Master Technische Physik 2011
- Master Technische Physik 2013

Systemtechnik der Bildverarbeitung

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min Art der Notengebung: Gestufte Noten
 Sprache: Deutsch Pflichtkennz.: Wahlpflichtfach Turnus: unbekannt

Fachnummer: 5582 Prüfungsnummer: 2100150

Fachverantwortlich: Prof. Dr.-Ing. habil. Franz Schmidt

Leistungspunkte: 8 Workload (h): 240 Anteil Selbststudium (h): 172 SWS: 6.0
 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Fachgebiet: 2116

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
				4	0	2															

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage die grundlegenden Prinzipien und Anforderungen der Systemtechnik der Bildverarbeitung zu bewerten und anzuwenden, sie sind mit der Theorie vertraut und in der Lage, praktische Aufgaben selbständig zu lösen. Sie können selbständig Applikationen der Bildverarbeitung von der Seite der Gerätetechnik realisieren.

Vorkenntnisse

Abgeschlossenes Grundstudium der Elektrotechnik, Informatik, Ingenieurinformatik oder Maschinenbau

Inhalt

- Anforderungen an Bildverarbeitungssysteme (technische Sehsysteme)
- Sensoren (Prinzip, strukturierte Sensoren, Bildaufnahmesensoren, CCD, Sensoren, die Videonorm)
- Multikanal (Farb) Sensoren (Farbaufnahmesysteme, Farbsensoren, Farbmatrik, Farbbildsensoren, Realisierung)
- Kameras (Schaltungstechnik, Abweichungen vom idealen Verhalten, CCD, Matrixsensor, Analogelektronik, Eigenschaften realisierter Systeme, Rechnerkopplung, Sonderanwendungen, Bildverstärker, Bildwandler)
- Beleuchtung (Grundgrößen, Beziehungen, Formeln, Lampen, Halbleiterstrahlungsquellen, Lichtwelligkeit, Flimmern, Beleuchtungseinrichtungen/ -systeme)
- Optische Abbildungssysteme (Grundbeziehungen der optischen Abbildung, Blenden, Tiefenschärfe, Sonderabbildungssysteme)
- Bildverarbeitungssysteme (Recheneinheiten , Bilddarstellung)
- Applikationen

Medienformen

Vorlesungsskript

Literatur

Vorlesungsskript

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Modul: Masterarbeit mit Kolloquium

Modulnummer7461

Modulverantwortlich:

Modulabschluss: Fachprüfung/Modulprüfung generiert

Lernergebnisse

Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten, die Ergebnisse klar und verständlich darzustellen sowie im Rahmen eines Abschlusskolloquiums zu präsentieren.

Vorraussetzungen für die Teilnahme

Für die schriftliche wissenschaftliche Arbeit gibt es keine Zulassungsvoraussetzung.
Das Abschlusskolloquium ist zulassungspflichtig.

Detailangaben zum Abschluss

Zwei Prüfungsleistungen: schriftliche wissenschaftliche Arbeit (sPL) und Abschlusskolloquium (mPL)

Master Optronik 2008

Modul: Masterarbeit mit Kolloquium

Masterarbeit - Abschlusskolloquium

Fachabschluss: Prüfungsleistung mündlich 30 min

Art der Notengebung: Gestufte Noten

Sprache: Deutsch oder Englisch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: unbekannt

Fachnummer: 7440

Prüfungsnummer: 99002

Fachverantwortlich: Jana Buchheim

Leistungspunkte: 5

Workload (h): 150

Anteil Selbststudium (h): 150

SWS: 0.0

Fakultät für Maschinenbau

Fachgebiet: 23

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
									150 h												

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden beherrschen die Darstellung von Forschungsergebnissen in komprimierter Form für ein allgemeines Publikum

Vorkenntnisse

Master-Arbeit

Inhalt

Die Masterarbeit ist in einem wissenschaftlich fundiertem Vortrag ergebnis- und methodenorientiert vorzustellen und die Ergebnisse sind in der Diskussion zu erläutern und zu verteidigen

Medienformen

Powerpoint-Präsentation oder gleichwertiges

Literatur

Ebeling, P. (1990). Rhetorik. Wiesbaden. Hartmann, M., Funk, R. & Niemann, H. (1998). Präsentieren. Präsentationen: zielgerichtet und adressatenorientiert. (4. Auflage). Weinheim: Beltz. Knill, M. (1991). Natürlich, zuhörerorientiert, aussagenzentriert reden. Motamedi, Susanne (1998). Präsentationen. Ziele, Konzeption, Durchführung. (2. Auflage). Heidelberg: Sauer-Verlag. Schilling, Gert (1998). Angewandte Rhetorik und Präsentationstechnik. Berlin: Gert Schilling Verlag.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Fahrzeugtechnik 2009

Master Fahrzeugtechnik 2014

Master Maschinenbau 2009

Master Maschinenbau 2011

Master Maschinenbau 2014

Master Mechatronik 2008

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Master Optronik 2008

Modul: Masterarbeit mit Kolloquium

Masterarbeit - schriftliche wissenschaftliche Arbeit

Fachabschluss: Masterarbeit schriftlich 6 Monate

Art der Notengebung: Generierte Noten

Sprache: Deutsch oder Englisch

Pflichtkennz.: Pflichtfach

Turnus: unbekannt

Fachnummer: 7439

Prüfungsnummer: 99001

Fachverantwortlich: Jana Buchheim

Leistungspunkte: 25

Workload (h): 750

Anteil Selbststudium (h): 750

SWS: 0.0

Fakultät für Maschinenbau

Fachgebiet: 23

	1.FS			2.FS			3.FS			4.FS			5.FS			6.FS			7.FS		
SWS nach Fachsemester	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P	V	S	P
									750 h												

Lernergebnisse / Kompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage, eigenständig eine wissenschaftliche Arbeit anzufertigen und deren Neuheitsgrad nach sowie deren Originalität nachzuweisen.

Vorkenntnisse

Fächer des Master-Studiums

Inhalt

Durchführung der Forschung/Entwicklung Dokumentation der Ergebnisse

Medienformen

-

Literatur

Bänsch, A.: Wissenschaftliches Arbeiten – Ein Leitfaden für Diplom- und Seminararbeiten. 7. Auflage, München et al., 1999.
Nicol, N., Albrecht, R.: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit Word - formvollendete und normgerechte Examens-, Diplom- und Doktorarbeiten. München et al., 2002. Niederhauser, J.: Die schriftliche Arbeit - ein Leitfaden zum Schreiben von Fach-, Seminar- und Abschlussarbeiten in der Schule und beim Studium. Mannheim et al., 2000. Theisen, M.: Wissenschaftliches Arbeiten - Technik, Methoden, Form. München, 2000.

Detailangaben zum Abschluss

verwendet in folgenden Studiengängen

Master Fahrzeugtechnik 2009

Master Fahrzeugtechnik 2014

Master Maschinenbau 2009

Master Maschinenbau 2011

Master Maschinenbau 2014

Master Mechatronik 2008

Master Optische Systemtechnik/Optronik 2014

Master Optronik 2008

Master Optronik 2010

Glossar und Abkürzungsverzeichnis:

LP	Leistungspunkte
SWS	Semesterwochenstunden
FS	Fachsemester
V S P	Angabe verteilt auf Vorlesungen, Seminare, Praktika
N.N.	Nomen nominandum, Nomen nescio, Platzhalter für eine noch unbekannte Person (wikipedia)
Objekttypen lt. Inhaltsverzeichnis	K=Kompetenzfeld; M=Modul; P,L,U= Fach (Prüfung,Lehrveranstaltung,Unit)